## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

10-276081

(43) Date of publication of application: 13.10.1998

(51) Int. Cl.

H03K 19/0175 H01L 21/8238 H01L 27/092 H03K 19/0948

(21) Application number : 09-079385

(71) Applicant: OKI MICRO DESIGN MIYAZAKI:KK

OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing:

31. 03. 1997

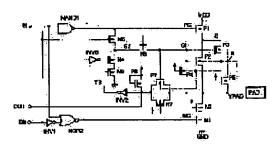
(72) Inventor: KONO HARUMI

SUSHIHARA AKIHIRO

#### (54) INPUT CIRCUIT, OUTPUT CIRCUIT AND INPUT/OUTPUT CIRCUIT

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To sufficiently secure a sufficient VIH margin, to cope with the process of weak breakdown voltage, to perform a high-speed operation and to reduce power consumption by raising an output terminal to an internal power supply level as well when an input/output terminal is raised to the internal power supply level. SOLUTION: When 5[V], for instance, is inputted to the input/output terminal YPAD, raising to the internal power supply VDD level (3 [V]) is not performed only by an NMOS transistor N7. Thus, by a PMOS transistor P7 formed at a floating bulk B, the output terminal OUT is raised to the internal power supply VDD and the VIH margin of an internal input circuit is sufficiently filled. Also, even when a voltage higher than the internal power supply VDD level is inputted to the input/output terminal YPAD, since the PMQS transistor P7 is turned OFF, the output terminal OUT is turned to



the internal power supply VDD level. Also, except the rising time of the input/output terminal YPAD, the flow-in of a current from the input/output terminal YPAD to the internal power supply VDD is not generated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.01.2002

[Date of sending the examiner's decision

of rejection]

[Kind of final disposal of application

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAvEa4.tDA410276081P1.htm

11/30/2005

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3544819

[Date of registration] 16.04.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出顧公開番号

# 特開平10-276081

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

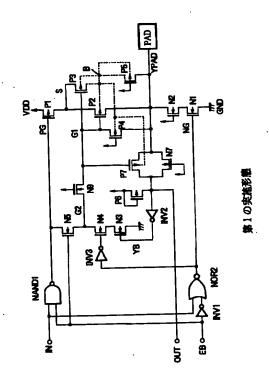
(51) Int.Cl. <sup>6</sup> H 0 3 K H 0 1 L	21/8238 27/092	識別記号	FI H03K 19/00 101F H01L 27/08 321L H03K 19/00 101K 101S
H03K	19/0948		19/094 B
			審査請求 未請求 請求項の数33 OL (全 32 頁)
(21) 出願番号		<b>特顧平9-79385</b>	(71)出顧人 591049893 株式会社沖マイクロデザイン宮崎
(22)出顧日		平成9年(1997)3月31日	宮崎県宮崎市大和町9番2号 (71)出頭人 000000295 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
			(72)発明者 河野 治美 宮崎県宮崎市大和町9番2号 株式会社沖 マイクロデザイン宮崎内
			(72)発明者 須志原 昭博 宮崎県宮崎市大和町9番2号 株式会社社 マイクロデザイン宮崎内
			(74)代理人 弁理士 前田 実

# (54) 【発明の名称】 入力回路および出力回路ならびに入出力回路

#### (57) 【要約】

【課題】 低消費電力化、動作の高速化、およびVIH マージンの向上を図る。

【解決手段】 内部電源VDDは外部電源VCCよりも低い。入出力端子YPADに電圧VCCが入力された場合には、YPADが電圧VCCに上昇するまでは、PMOSトランジスタP7がONしており、YPADがVDDより高くなると、P7がOFFする。従って出力端子OUTは内部電源レベルとなる。またYPADから"H"レベルの電圧を出力する場合には、YPADが電圧VDDに上昇するまでは、PMOSトランジスタP2がONし、YPADがVDDより高くなるとP2がOFFする。従って、YPADはVDDまでは高速に上昇し、その後、プルアップ抵抗R1により外部電源レベルまで上昇する。



(2)

30

1

#### -【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲート電極が第1のノードに接続され、 第1電極が第1の電源に接続され、第2電極が第2のノ ードに接続された第1のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第3のノードに接続され、第1電極が前記 第2のノードに接続され、第2電極が第4のノードに接 **続され、基板がフローティング状態である第5のノード** に接続された第2のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第6のノードに接続され、第1電極が前記 第3のノードに接続され、第2電極が前記第4のノード に接続され、基板が前記第5のノードに接続された第3 のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第6のノードに接続され、第1電極が 前記第3のノードに接続され、第2電極が第2の電源に 接続された第4のMOSトランジスタと、

入力端子が前記第4のノードに接続され、出力端子が前 記第6のノードに接続されたインバータとを有すること を特徴とする出力回路。

【請求項2】 前記第3のMOSトランジスタのゲート 電極と、前記第4のトランジスタのゲート電極の間に遅 延回路を設けたことを特徴とする請求項1記載の出力回 路。

ゲート電極が前記第3のノードに接続さ 【請求項3】 れ、第1電極が前記第2のノードに接続され、第2電極 および基板が前記第5のノードに接続された第5のMO Sトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項 1 記載の出力回路。

ゲート電極が前記第1の電源に接続さ 【請求項4】 れ、第1電極が前記第4のノードに接続され、第2電極 および基板が前記第5のノードに接続された第5のMO Sトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項 1 記載の出力回路。

【請求項5】 前記第1のノードに接続する第1の入力 端子と、

第7のノードに接続する第2の入力端子と、

前記第4のノードに接続する出力端子と、

ゲート電極が前記第7のノードに接続され、第1電極が 前記第2の電源に接続され、第1電極が前記第4のノー ドに接続された第5のMOSトランジスタとをさらに有 することを特徴とする請求項1記載の出力回路。

【請求項6】 ゲート電極が第1のノードに接続され、 第1電極が第1の電源に接続され、第2電極が第2のノ ードに接続された第1のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第3のノードに接続され、第1電極が前記 第2のノードに接続され、第2電極が第4のノードに接 **続され、基板がフローティング状態である第5のノード** に接続された第2のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第6のノードに接続され、第1電極が前記 第3のノードに接続され、第2電極が前記第4のノード に接続され、基板が前記第5のノードに接続された第3 のMOSトランジスタと、 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前

記第4のノードに接続され、第2電極が第7のノードに 接続された第4のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第3のノードに接続され、第1電極が 前記第7のノードに接続され、第2電極が前記第4のノ ードに接続され、基板が前記第5のノードに接続された 第5のMOSトランジスタと、

入力端子が前記第7のノードに接続され、出力端子が第 8のノードに接続されたインバータと、

ゲート電極が前記第8のノードに接続され、第1電極が 第2の電源に接続され、第2電極が前記第6のノードに 接続された第6のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第6のノードに接続され、第2電極が前記第3のノー ドに接続された第7のMOSトランジスタとを有するこ とを特徴とする出力回路。

【請求項7】 ゲート電極および第1電極が前記第1の 電源に接続され、第2電極が前記第7のノードに接続さ れた第8のMOSトランジスタをさらに有することを特 徴とする請求項6記載の出力回路。

【請求項8】 ゲート電極が前記第3のノードに接続さ れ、第1電極が前記第2のノードに接続され、第2電極 および基板が前記第5のノードに接続された第8のMO Sトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項 6 記載の出力回路。

【請求項9】 ゲート電極が前記第1の電源に接続さ れ、第1電極が前記第4のノードに接続され、第2電極 および基板が前記第5のノードに接続された第8のMO Sトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項 6 記載の出力回路。

【請求項10】 前記第1のノードに接続する第1の入 力端子と、

第9のノードに接続する第2の入力端子と、

前記第4のノードに接続する出力端子と、

ゲート電極が前記第9のノードに接続され、第1電極が 前記第2の電源に接続され、第2電極が第10のノード に接続された第8のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 40 記第10のノードに接続され、第2電極が前記第4のノ ードに接続された第9のMOSトランジスタとをさらに 有することを特徴とする請求項6記載の出力回路。

【請求項11】 ゲート電極が第1のノードに接続さ れ、第1電極が第1の電源に接続され、第2電極が第2 のノードに接続された第1のMOSトランジスタと、 ゲート電極が第3のノードに接続され、第1電極が前記 第2のノードに接続され、第2電極が第4のノードに接 **続され、基板がフローティング状態である第5のノード** に接続された第2のMOSトランジスタと、

50 ゲート電極が第6のノードに接続され、第1電極が前記

第3のノードに接続され、第2電極が前記第4のノード に接続され、基板が前記第5のノードに接続された第3 のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第4のノードに接続され、第2電極が第7のノードに 接続された第4のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第3のノードに接続され、第1電極が 前記第7のノードに接続され、第2電極が前記第4のノ ードに接続され、基板が前記第5のノードに接続された 第5のMOSトランジスタと、

第1入力端子が前記第7のノードに接続され、第2入力 端子が第8のノードに接続され、出力端子が第9のノー ドに接続されたNORゲートと、

ゲート電極が前記第9のノードに接続され、第1電極が 第2の電源に接続され、第2電極が第10のノードに接 続された第6のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第10のノードに接続され、第2電極が前記第3のノ ードに接続された第7のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第3のノードに接続され、第2電極が第11のノード に接続された第8のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第8のノードに接続され、第1電極が 前記第11のノードに接続され、第2電極が前記第1の ノードに接続された第9のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第12のノードに接続され、第1電極が前 記第10のノードに接続され、第2電極が前記第6のノ ードに接続された第10のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第12のノードに接続され、第1電極 が前記第1の電源に接続され、第2電極が前記第6のノ ードに接続された第11のMOSトランジスタとを有す ることを特徴とする出力回路。

【請求項12】 ゲート電極および第1電極が前記第1 の電源に接続され、第2電極が前記第7のノードに接続 された第12のMOSトランジスタをさらに有すること を特徴とする請求項11記載の出力回路。

ゲート電極が前記第3のノードに接続 【請求項13】 され、第1電極が前記第2のノードに接続され、第2電 極および基板が前記第5のノードに接続された第12の MOSトランジスタをさらに有することを特徴とする請 求項11記載の出力回路。

【請求項14】 ゲート電極が前記第1の電源に接続さ れ、第1電極が前記第4のノードに接続され、第2電極 および基板が前記第5のノードに接続された第12のM OSトランジスタをさらに有することを特徴とする請求 項11記載の出力回路。

【請求項15】 前記第1のノードに接続する第1の入 力端子と、

第13のノードに接続する第2の入力端子と、

前記第12のノードに接続する第3の入力端子と、

前記第8のノードに接続する第4の入力端子と、 前記第4のノードに接続する出力端子と、

ゲート電極が前記第13のノードに接続され、第1電極 が前記第2の電源に接続され、第2電極が第14のノー ドに接続された第12のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第14のノードに接続され、第2電極が前記第4のノ ードに接続された第13のMOSトランジスタとをさら に有することを特徴とする請求項11記載の出力回路。

【請求項16】 ゲート電極および第1電極が第1の電 10 源に接続され、第2電極が第1のノードに接続された第 1のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第2のノードに接続され、第1電極が前記 第1のノードに接続され、第2電極が第3のノードに接 続され、基板がフローティング状態である第4のノード に接続された第2のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第2のノードに接続され、第2電極が前記第3のノー ドに接続され、基板が前記第4のノードに接続された第 3のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第3のノードに接続され、第2電極が第5のノードに・ 接続された第4のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第2のノードに接続され、第1電極が 前記第5のノードに接続され、第2電極が前記第3のノ ードに接続され、基板が前記第4のノードに接続された 第5のMOSトランジスタと、

入力端子が前記第5のノードに接続され、出力端子が第 6のノードに接続されたインバータと、

ゲート電極が前記第6のノードに接続され、第1電極が 第2の電源に接続され、第2電極が第7のノードに接続 された第6のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第7のノードに接続され、第2電極が前記第2のノー ドに接続された第7のMOSトランジスタとを有するこ とを特徴とする入力回路。

【請求項17】 ゲート電極および第1電極が前記第1 の電源に接続され、第2電極が前記第5のノードに接続 された第8のMOSトランジスタをさらに有することを 40 特徴とする請求項16記載の入力回路。

【請求項18】 ゲート電極が前記第2の電源に接続さ れ、第1電極が前記第1の電源に接続され、第2電極が 前記第5のノードに接続された第8のMOSトランジス 夕をさらに有することを特徴とする請求項16記載の入 力回路。

【請求項19】 ゲート電極が前記第1の電源に接続さ れ、第1電極が前記第5のノードに接続され、第2電極 が前記第2の電源に接続された第8のMOSトランジス 夕をさらに有することを特徴とする請求項16記載の入 50 力回路。

【請求項20】 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第3のノードに接続され、第2電極が第8のノードに接続された第8のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第8のノードに接続され、第1電極が 前記第1の電源に接続され、第2電極が前記第3のノー ドに接続され、基板が前記第4のノードに接続された第 9のMOSトランジスタとをさらに有することを特徴と する請求項16記載の入力回路。

【請求項21】 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第2の電源に接続され、第1電極が第8のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第8のノードに接続され、第2電極が前記第3のノードに接続された第9のMOSトランジスタとをさらに有することを特徴とする請求項16記載の入力回路。

【請求項22】 ゲート電極が前記第2のノードに接続され、第1電極が前記第1のノードに接続され、第2電極および基板が前記第4のノードに接続された第8のMOSトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項16記載の入力回路。

【請求項23】 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第3のノードに接続され、第2電極および基板が前記第4のノードに接続された第8のMOSトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項16記載の入力回路。

【請求項24】 前記第3のノードに接続する入力端子

前記第5のノードに接続する出力端子と、

ゲート電極および第1電極が前記第2の電源に接続され、第1電極が第8のノードに接続された第8のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第8のノードに接続され、第2電極が前記第3のノー ドに接続された第9のMOSトランジスタとをさらに有 することを特徴とする請求項16記載の入力回路。

【請求項25】 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第8のノードに接続され、第2電極が前記第2の電源に接続された第10のMOSトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項24記載の入力回路。

【請求項26】 第1のノードに接続する入力端子と、ゲート電極が前記第1のノードに接続され、第1電極が第1の電源に接続され、第2電極および基板がフローティング状態である第2のノードに接続された第1のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第1のノードに接続され、第2電極が第3のノードに 接続され、基板が前記第2のノードに接続された第2の MOSトランジスタと、

第1端子が前記第3のノードに接続され、第2端子が第 2の電源に接続された負荷回路と、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第3のノードに接続され、第2電極が第4のノードに 接続された第3のMOSトランジスタと、

入力端子が前記第4のノードに接続され、出力端子が第 5のノードに接続されたコンパレータ回路と、

前記第5のノードに接続された出力端子とを有すること 10 を特徴とする入力回路。

【請求項27】 第1のノードに接続する入力端子と、ゲート電極が前記第1のノードに接続され、第1電極が第1の電源に接続され、第2電極および基板がフローティング状態である第2のノードに接続された第1のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第1のノードに接続され、第2電極が第3のノードに 接続され、基板が前記第2のノードに接続された第2の MOSトランジスタと、

20 第1端子が前記第3のノードに接続され、第2端子が第2の電源に接続された負荷回路と、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第3のノードに接続され、第2電極が第4のノードに接続された第20MOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第4のノードに接続され、第1電極が 第5のノードに接続され、第2電極が前記第2の電源に 接続された第4のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第4のノードに接続され、第1電極および基板が第6のノードに接続され、第2電極が前記第 30 5のノードに接続された第5のMOSトランジスタと、

入力電極が前記第5のノードに接続され、出力電極が第 7のノードに接続されたインバータと、

ゲート電極が前記第7のノードに接続され、第1電極が 前記第1の電源に接続され、第2電極が前記第6のノー ドに接続された第6のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第7のノードに接続され、第1電極が 前記第6のノードに接続され、第2電極が前記第1の電 源に接続された第7のMOSトランジスタと、

前記第7のノードに接続された出力端子とを有すること 40 を特徴とする入力回路。

【請求項28】 請求項12記載の出力回路と、請求項26または請求項27に記載の入力回路からなり、

前記出力回路の第3の入力端子と前記入力回路の出力端子とを接続し、前記出力回路の出力端子を外部回路に接続し、前記入力回路の入力端子を前記外部回路の電源に接続したことを特徴とする入出力回路。

【請求項29】 ゲート電極が第1のノードに接続され、第1電極が第1の電源に接続され、第2電極が第2のノードに接続された第1のMOSトランジスタと、

50 ゲート電極が第3のノードに接続され、第1電極が前記

7

第2のノードに接続され、第2電極が第4のノードに接続され、基板がフローティング状態である第5のノード.に接続された第2のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第3のノードに接続され、第2電極が前記第4のノードに接続され、基板が前記第5のノードに接続された第3のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第4のノードに接続され、第2電極が第6のノードに 接続された第4のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第3のノードに接続され、第1電極が 前記第6のノードに接続され、第2電極が前記第4のノ ードに接続され、基板が前記第5のノードに接続された 第5のMOSトランジスタと、

入力端子が前記第6のノードに接続され、出力端子が第7のノードに接続されたインバータと、

ゲート電極が前記第7のノードに接続され、第1電極が 第2の電源に接続され、第2電極が第8のノードに接続 された第6のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第9のノードに接続され、第1電極が前記 第8のノードに接続され、第2電極が第10のノードに 接続された第7のMOSトランジスタと、

ゲート電極が第11のノードに接続され、第1電極が前 記第10のノードに接続され、第2電極が前記第1のノ ードに接続された第8のMOSトランジスタと、

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第10のノードに接続され、第2電極が前記第3のノ ードに接続された第9のMOSトランジスタとを有する ことを特徴とする入出力回路。

【請求項30】 ゲート電極および第1電極が前記第1の電源に接続され、第2電極が前記第6のノードに接続された第10のMOSトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項29記載の入出力回路。

【請求項31】 ゲート電極が前記第3のノードに接続され、第1電極が前記第2のノードに接続され、第2電極および基板が前記第5のノードに接続された第10のMOSトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項29記載の入出力回路。

【請求項32】 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第4のノードに接続され、第2電極および基板が前記第5のノードに接続された第10のMOSトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項29記載の入出力回路。

【請求項33】 前記第1のノードに接続する第1の入力端子と、

前記第11のノードに接続された第2の入力端子と、 前記第9のノードに接続された第3の入力端子と、

第12のノードに接続された第4の入力端子と、

前記第6のノードに接続された出力端子と、

前記第4のノードに接続された入出力端子と、

ゲート電極が前記第12のノードに接続され、第1電極 が前記第2の電源に接続され、第2電極が第13のノー ドに接続された第10のMOSトランジスタと、

8

ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第13のノードに接続され、第2電極が前記第4のノ ードに接続された第11のMOSトランジスタとをさら に有することを特徴とする請求項29記載の入力回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路装置に用いられる入力回路、出力回路、入出力回路に関するものであり、特に、内部電源電圧よりも高い信号電圧が入力される場合に有効な入力回路および入出力回路、信号出力端子の電圧が電源電圧よりも高くなる場合に有効な出力回路および入出力回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図24は半導体集積回路装置(LSIチップ)に用いられる従来の入力回路を示す回路図である。また図25は図24に示す従来の入力回路における動作タイミング図である。図24に示す入力回路は、耐圧の弱いプロセスによるLSIに用いられ、外部からの0~5[V]振幅の入力信号を、常時ONとなっているNMOSトランジスタN100により0~(VDD-NMOSしきい値電圧)までの振幅にして、同一チップの内部回路に与えるものであった。そして、内部回路のしさい値を低めに設定していた。

【0003】また、図26はLSIチップに用いられる 従来の出力回路を示す回路図である。また図27は図26に示す従来の出力回路における動作タイミング図である。図26に示す出力回路は、耐圧の弱いプロセスによりLSIに用いられ、常時ONしているNMOSトランジスタN101を設けたオープンドレイン回路を、外部に設けられた、5[V]へのプルアップ抵抗R1に接続したものであった。NMOSトランジスタN101により、N102のドレイン、ソース電極間には5[V]の 電位差は生じない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】図24に示した従来の入力回路では、内部電源電圧VDDを3[V]とする40と、5[V]の電圧が入力されたときに、ノードYの電位はVDD-NMOS閾値となるので、約2.3[V]となる。そのため、入力回路のVIH規格に対して厳しくなるという問題があった。VIH規格とは、入力回路からの"H"レベル電圧に、内部回路のしきい値に対して充分なマージンを持たせることができているか否かを示す規格である。

【0005】また図26に示した従来の出力回路では、 出力波形の立ち上がりはプルアップ抵抗R1の値により 決定され、高速に動作させるためにはR1の抵抗値を小 50 さくする必要がある。しかし抵抗値を小さくすることに

50

9

より電流を多く消費することになる。逆に消費電流を小さくするために抵抗値を大きくすると、出力波形の立ち上がりが遅くなり高速性を損なうという問題点があった。

【0006】本発明はこのような従来の問題を解決するものであり、充分なVIHマージンを充分に確保することができ、耐圧の弱いプロセスに対応でき、高速動作が可能であり、かつ消費電流が小さい入力回路、出力回路、および入出力回路を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに本発明の請求項1記載の出力回路は、ゲート電極が 第1のノードに接続され、第1電極が第1の電源に接続 され、第2電極が第2のノードに接続された第1のM〇 Sトランジスタと、ゲート電極が第3のノードに接続さ れ、第1電極が前記第2のノードに接続され、第2電極 が第4のノードに接続され、基板がフローティング状態 である第5のノードに接続された第2のMOSトランジ スタと、ゲート電極が第6のノードに接続され、第1電 極が前記第3のノードに接続され、第2電極が前記第4 のノードに接続され、基板が前記第5のノードに接続さ れた第3のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第 6のノードに接続され、第1電極が前記第3のノードに 接続され、第2電極が第2の電源に接続された第4のM OSトランジスタと、入力端子が前記第4のノードに接 続され、出力端子が前記第6のノードに接続されたイン バータとを有することを特徴とする。

【0008】本発明の請求項6記載の出力回路は、ゲー ト電極が第1のノードに接続され、第1電極が第1の電 源に接続され、第2電極が第2のノードに接続された第 1のMOSトランジスタと、ゲート電極が第3のノード に接続され、第1電極が前記第2のノードに接続され、 第2電極が第4のノードに接続され、基板がフローティ ング状態である第5のノードに接続された第2のMOS トランジスタと、ゲート電極が第6のノードに接続さ れ、第1電極が前記第3のノードに接続され、第2電極 が前記第4のノードに接続され、基板が前記第5のノー ドに接続された第3のMOSトランジスタと、ゲート電 極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第4の ノードに接続され、第2電極が第7のノードに接続され た第4のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第3 のノードに接続され、第1電極が前記第7のノードに接 続され、第2電極が前記第4のノードに接続され、基板 が前記第5のノードに接続された第5のMOSトランジ スタと、入力端子が前記第7のノードに接続され、出力 端子が第8のノードに接続されたインパータと、ゲート 電極が前記第8のノードに接続され、第1電極が第2の 電源に接続され、第2電極が前記第6のノードに接続さ れた第6のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第 1の電源に接続され、第1電極が前記第6のノードに接

10 続され、第2電極が前記第3のノードに接続された第7 のMOSトランジスタとを有することを特徴とする。 【0009】本発明の請求項11記載の出力回路は、ゲ ート電極が第1のノードに接続され、第1電極が第1の 電源に接続され、第2電極が第2のノードに接続された 第1のMOSトランジスタと、ゲート電極が第3のノー ドに接続され、第1電極が前記第2のノードに接続さ れ、第2電極が第4のノードに接続され、基板がフロー ティング状態である第5のノードに接続された第2のM 10 OSトランジスタと、ゲート電極が第6のノードに接続 され、第1電極が前記第3のノードに接続され、第2電 極が前記第4のノードに接続され、基板が前記第5のノ ードに接続された第3のMOSトランジスタと、ゲート 電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第4 のノードに接続され、第2電極が第7のノードに接続さ れた第4のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第 3のノードに接続され、第1電極が前記第7のノードに 接続され、第2電極が前記第4のノードに接続され、基 板が前記第5のノードに接続された第5のMOSトラン ジスタと、第1入力端子が前記第7のノードに接続さ れ、第2入力端子が第8のノードに接続され、出力端子 が第9のノードに接続されたNORゲートと、ゲート電 極が前記第9のノードに接続され、第1電極が第2の電 源に接続され、第2電極が第10のノードに接続された 第6のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第1の 電源に接続され、第1電極が前記第10のノードに接続 され、第2電極が前記第3のノードに接続された第7の MOSトランジスタと、ゲート電極が前記第1の電源に 接続され、第1電極が前記第3のノードに接続され、第 2 電極が第11のノードに接続された第8のMOSトラ ンジスタと、ゲート電極が前記第8のノードに接続さ れ、第1電極が前記第11のノードに接続され、第2電 極が前記第1のノードに接続された第9のMOSトラン ジスタと、ゲート電極が第12のノードに接続され、第 1 電極が前記第10のノードに接続され、第2電極が前 記第6のノードに接続された第10のMOSトランジス タと、ゲート電極が前記第12のノードに接続され、第 1 電極が前記第1の電源に接続され、第2電極が前記第

を有することを特徴とする。
【0010】また、本発明の請求項16記載の入力回路は、ゲート電極および第1電極が第1の電源に接続され、第2電極が第1のノードに接続された第1のMOSトランジスタと、ゲート電極が第2のノードに接続され、第2電極が第3のノードに接続され、基板がフローティング状態である第4のノードに接続された第2のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前記第2のノードに接続され、第2電極が前記第3のノードに接続され、基板が前記第4のノードに接続

6のノードに接続された第11のMOSトランジスタと

された第3のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記 第1の電源に接続され、第1電極が前記第3のノードに 接続され、第2電極が第5のノードに接続された第4の MOSトランジスタと、ゲート電極が前記第2のノード に接続され、第1電極が前記第5のノードに接続され、 第2電極が前記第3のノードに接続され、基板が前記第 4のノードに接続された第5のMOSトランジスタと、 入力端子が前記第5のノードに接続され、出力端子が 6のノードに接続されたインバータと、ゲート電極が前 記第6のノードに接続され、第1電極が第2の電源に接 続され、第2電極が第7のノードに接続された第6のM OSトランジスタと、ゲート電極が前記第1の電源に接 続され、第1電極が前記第7のノードに接続され、第2 電極が前記第7のノードに接続された第7のMOSトランジスタとを有することを特徴とする。

【0011】本発明の請求項26記載の入力回路は、第 1のノードに接続する入力端子と、ゲート電極が前記第 1のノードに接続され、第1電極が第1の電源に接続さ れ、第2電極および基板がフローティング状態である第 2のノードに接続された第1のMOSトランジスタと、 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第1のノードに接続され、第2電極が第3のノードに 接続され、基板が前記第2のノードに接続された第2の MOSトランジスタと、第1端子が前記第3のノードに 接続され、第2端子が第2の電源に接続された負荷回路 と、ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極 が前記第3のノードに接続され、第2電極が第4のノー ドに接続された第3のMOSトランジスタと、入力端子 が前記第4のノードに接続され、出力端子が第5のノー ドに接続されたコンパレータ回路と、前記第5のノード に接続された出力端子とを有することを特徴とする。

【0012】本発明の請求項27記載の入力回路は、第 1のノードに接続する入力端子と、ゲート電極が前記第 1のノードに接続され、第1電極が第1の電源に接続さ れ、第2電極および基板がフローティング状態である第 2のノードに接続された第1のMOSトランジスタと、 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第1のノードに接続され、第2電極が第3のノードに 接続され、基板が前記第2のノードに接続された第2の MOSトランジスタと、第1端子が前記第3のノードに 接続され、第2端子が第2の電源に接続された負荷回路 と、ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極 が前記第3のノードに接続され、第2電極が第4のノー ドに接続された第3のMOSトランジスタと、ゲート電 極が前記第4のノードに接続され、第1電極が第5のノ ードに接続され、第2電極が前記第2の電源に接続され た第4のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第4 のノードに接続され、第1電極および基板が第6のノー ドに接続され、第2電極が前記第5のノードに接続され た第5のMOSトランジスタと、入力電極が前記第5の ノードに接続され、出力電極が第7のノードに接続されたインバータと、ゲート電極が前記第7のノードに接続され、第1電極が前記第1の電源に接続され、第2電極が前記第6のノードに接続された第6のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第7のノードに接続され、第1電極が前記第6のノードに接続され、第2電極が前記第1の電源に接続された第7のMOSトランジスタと、前記第7のノードに接続された出力端子とを有すること

を特徴とする。 【0013】また本発明の請求項29記載の入出力回路 10 は、ゲート電極が第1のノードに接続され、第1電極が 第1の電源に接続され、第2電極が第2のノードに接続 された第1のMOSトランジスタと、ゲート電極が第3 のノードに接続され、第1電極が前記第2のノードに接 続され、第2電極が第4のノードに接続され、基板がフ ローティング状態である第5のノードに接続された第2 のMOSトランジスタと、ゲート電極が前記第1の電源 に接続され、第1電極が前記第3のノードに接続され、 第2電極が前記第4のノードに接続され、基板が前記第 5のノードに接続された第3のMOSトランジスタと、 ゲート電極が前記第1の電源に接続され、第1電極が前 記第4のノードに接続され、第2電極が第6のノードに 接続された第4のMOSトランジスタと、ゲート電極が 前記第3のノードに接続され、第1電極が前記第6のノ ードに接続され、第2電極が前記第4のノードに接続さ れ、基板が前記第5のノードに接続された第5のMOS トランジスタと、入力端子が前記第6のノードに接続さ れ、出力端子が第7のノードに接続されたインパータ と、ゲート電極が前記第7のノードに接続され、第1電 極が第2の電源に接続され、第2電極が第8のノードに 接続された第6のMOSトランジスタと、ゲート電極が 第9のノードに接続され、第1電極が前記第8のノード に接続され、第2電極が第10のノードに接続された第 7のMOSトランジスタと、ゲート電極が第11のノー ドに接続され、第1電極が前記第10のノードに接続さ れ、第2電極が前記第1のノードに接続された第8のM OSトランジスタと、ゲート電極が前記第1の電源に接 続され、第1電極が前記第10のノードに接続され、第 2 電極が前記第3のノードに接続された第9のMOSト ランジスタとを有することを特徴とする。

[0014]

【発明の実施の形態】

第1の実施形態

図1は本発明の第1の実施形態の入出力回路を示す回路 図である。図1に示す入出力回路は、LSIチップに内 蔵されており、入力端子INと、イネーブル入力端子E Bと、出力端子OUTと、入出力端子YPADと、2入 力のNANDゲート1と、2入力のNORゲート2と、 PMOSトランジスタP1~P7と、NMOSトランジ スタN1~N5、N7、N9と、インバータINV1~

INV3とを有する。このLSIチップの内部電源VD Dは、ここでは3[V]とする。入出力端子YPADに は、このLSIチップの外部に設けられた外部回路(図 示しない) が接続されているものとする。入出力端子Y PADは、外部回路が図1の入出力回路に信号電圧を入 カし、また図1の入出力回路が外部回路に信号電圧を出 力するするための端子である。外部電源VCCは、ここ では5 [V] とする。また外部回路が入出力端子YPA Dに入力する信号電圧の"H"レベルは、外部電源VC Cレベル(5 [V]) であるものとする。

13

【0015】NANDゲート1は、その第1入力端子が 入力端子INに接続され、その第2入力端子がイネーブ ル入力端子EBに接続され、その出力端子が内部ノード PGに接続されている。NORゲート2はその第1入力 端子が入力端子INに接続され、その第2入力端子がイ ンバータINV1を介してイネーブル入力端子EBに接 続され、その出力端子が内部ノードNGに接続されてい る。

【0016】NMOSトランジスタN1は、そのゲート 電極がノードNGに接続され、そのソース電極が接地電 源GNDに接続されている。NMOSトランジスタN2 は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、その ドレイン電極が端子YPADに接続され、そのソース電 極がNMOSトランジスタN1のドレイン電極に接続さ れている。

【0017】NMOSトランジスタN3は、そのゲート 電極がインパータINV2を介して出力端子OUTに接 続され、そのソース電極が接地電源GNDに接続されて いる。NMOSトランジスタN4は、そのゲート電極が インパータINV3を介してノードNGに接続され、そ のドレイン電極が内部ノードG2に接続され、そのソー ス電極がNMOSトランジスタN3のドレイン電極に接 続されている。NMOSトランジスタN5は、そのゲー ト電極がイネーブル端子EBに接続され、そのドレイン 電極がノードPGに接続され、そのソース電極がノード G2に接続されている。NMOSトランジスタN9は、 そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのドレ イン電極がノードG2に接続され、そのソース電極がノ ードG1に接続されている。

【0018】PMOSトランジスタP1は、そのゲート 電極がノードPGに接続され、そのソース電極が内部電 **源VDDに接続され、そのドレイン電極は内部ノードS** に接続されている。PMOSトランジスタP2は、その ゲート電極がノードG1に接続され、そのドレイン電極 が入出力端子YPADに接続され、そのソース電極がノ ードSに接続されている。PMOSトランジスタP3 は、そのゲート電極がノードG1に接続され、そのソー ス電極がノードSに接続されている。PMOSトランジ スタP4は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続さ れ、ドレイン電極がノードG1に接続され、そのソース 電極が入出力端子YDADに接続されている。PMOS トランジスタP5は、そのゲート電極が内部電源VDD に接続され、そのソース電極が入出力端子YDADに接 続されている。

【0019】NMOSトランジスタN7は、そのゲート 電極が内部電源VDDに接続され、その第1電極(ドレ イン電極またはソース電極)が入出力端子YPADに接 **続され、その第2電極(ソース電極またはドレイン電** 極)が出力端子OUTに接続されている。PMOSトラ 10 ンジスタP7は、そのゲート電極がノードG1に接続さ れ、その第1電極(ドレイン電極またはソース電極)が 出力端子OUTに接続され、その第2電極(ソース電極 またはドレイン電極)が入出力端子YPADに接続され ている。PMOSトランジスタP6は、そのゲート電極 およびソース電極が内部電源VDDに接続され、ドレイ ン電極が出力端子OUTに接続されている。

【0020】PMOSトランジスタP2、P3、P4、 P5、P7は共通のバルク(基板)Bに形成されてい る。このフローティングパルクBは、内部電源VDDお よび接地電源GNDのいずれにも接続されていないNウ エルである。PMOSトランジスタP3およびP5のド レイン電極はフローティングバルクBに接続されてい る。PMOSトランジスタP1およびP6のパルクは内 部電源VDDに接続されており、NMOSトランジスタ N1~N5、N7、N9のパルクは接地電源GNDに接 続されている。

【0021】入出力端子YPADには、PMOSトラン ジスタP2のドレイン電極と、P4、P5の各ソース電 極と、P7の第2電極と、NMOSトランジスタN2の ドレイン電極と、N7の第1電極とが接続されている。 ノードPGには、NANDゲート1の出力端子と、PM OSトランジスタP1のゲート電極と、NMOSトラン ジスタN5のドレイン電極とが接続されている。ノード NGには、NORゲート2の出力端子と、インパータI NV3の入力端子と、NMOSトランジスタN1のゲー ト電極とが接続されている。ノードG1には、PMOS トランジスタP2、P3、P7の各ゲート電極と、PM OSトランジスタP4のドレイン電極と、NMOSトラ ンジスタN9のソース電極とが接続されている。ノード 40 G2には、NMOSトランジスタN5のソース電極と、 N4、N9の各ドレイン電極とが接続されている。ノー ドSには、PMOSトランジスタP1のドレイン電極 と、P2、P3の各ソース電極とが接続されている。出 力端子〇UTには、インパータINV2の入力端子と、 PMOSトランジスタP6のドレイン電極と、P7の第 1 電極と、NMOSトランジスタN7の第2電極とが接 続されている。

【0022】次に、図1に示す入出力回路の動作を説明 する。図2は図1に示す入出力回路が入力回路として動 50 作したときの動作タイミング図であり、(a) および

15

(b) は各部の電圧波形、(c) は消費電流波形を示す。図1の入出力回路は、イネーブル入力端子EBが"し"レベルのとき、図示しない外部回路から入出力端子YPADに入力された信号を出力端子OUTから出力する入力回路として動作し、またイネーブル入力端子EBが"H"レベルのとき、入力端子INに入力された信号を入出力端子YPADから出力する出力回路として動作する。

【0023】まず、イネーブル入力端子EBが"L"レベル(0 [V])に設定されているときの動作を説明する。NANDゲート1の出力すなわちノードPGは"H"レベル(3 [V])となるので、PMOSトランジスタP1はOFFしている。インパータINV1の出力は"H"レベルとなり、NORゲート2の出力すなわちノードNGは"L"レベルとなるので、NMOSトランジスタN1はOFFしている。またイネーブル入力端子EBが"L"レベルなので、NMOSトランジスタN5はOFFしている。ノードNGが"L"レベルなので、インパータINV3の出力は"H"レベルとなり、これによりNMOSトランジスタN4はONしている。

【0024】このようにイネーブル入力端子EBが"L"レベルのとき、PMOSトランジスタP1、NMOSトランジスタP1、NMOSトランジスタN1はともにOFFしており、入力端子INのレベルにかかわらず、入出力端子YPADのインピーダンス(入出力端子YPADから入出力回路側を見たインピーダンス)は高インピーダンスとなる。すなわち、イネーブル入力端子EBが"L"レベルに設定されて入力回路として動作するとき、出力端子YPADは高インピーダンスとなる。

【0025】入出力端子YPADが"L"レベル(0[V])のとき、NMOSトランジスタN7はONしており、出力端子OUTは"L"レベルとなる。出力端子OUTが"L"レベルなので、インバータINV2の出力は"H"レベルとなり、これによりNMOSトランジスタN3はONしており、またN4もONしている。NMOSトランジスタN3およびN4がONしているので、ノードG2は"L"レベルとなっている。ノードG2が"L"レベルなので、NMOSトランジスタN9がONしており、これによりノードG1は"L"レベルとなっている。

【0026】次に入出力端子YPADが"L"レベルから外部電源VCCレベル(5 [V])に変化すると、出力端子OUTは内部電源VDDレベルに変化する。ここで、説明の簡単化のため、PMOSトランジスタのしきい値電圧の絶対値と、NMOSトランジスタのしきい値とは等しいものとし、これをVthとする。

【0027】入出力端子YPADがVthまで上昇すると、ノードG1が" L" レベルなので、PMOSトランジスタP7がターンONする。またNMOSトランジスタN7は、入出力端子YPADの電位が3 [V] -Vt

h以下であるときONしており、3 [V] -V t n以上となるとターンOFFする。従って、入出力端子YPADが3 [V] まで上昇したとき、PMOSトランジスタP7およびNMOSトランジスタN7により、出力端子OUTは3 [V] -V t hではなく3 [V] まで上昇する

16

【0028】また入出力端子YPADがVthまで上昇すると、ノードG1が"L"レベルなので、PMOSトランジスタP2がターンONする。PMOSトランジスタP2のターンONにより、ノードSは入出力端子YPADと同じ電位に上昇し、これによりPMOSトランジスタP3もターンONする。PMOSトランジスタP2およびP3のターンONにより、フローティングパルクBは入出力端子YPADと同じ電位となる。

【0029】入出力端子YPADおよび出力端子OUTが3 [V] に上昇すると、インバータ INV2の出力が" H" レベルから" L" レベルに変化し、これにより NMOSトランジスタN3がターンOFFする。しかし、ノードG1は" L" レベルのままである。

20 【0030】さらに入出力端子YPADの電位が3
[V]+Vthに上昇すると、PMOSトランジスタP4およびP5がターンONする。PMOSトランジスタP4のターンONにより、ノードG1は"L"レベルから入出力端子YPADおよびノードSと同じ電位に変化する。ノードG1と入出力端子YPADとが同じ電位になることにより、PMOSトランジスタP7がターンOFFする。ノードG1と出力端子YPADとが同じ電位になることにより、PMOSトランジスタP2およびP3がターンOFFする。またPMOSトランジスタP5のターンONにより、フローティングバルクBの電位は入出力端子YPADと同じ電位となる。

【0031】そして、入出力端子YPADが最終的に外部電源電圧VCCレベル(5[V])となったとき、フローティングパルクB、ノードG1およびフローティングパルクBも5[V]となる。もしも、PMOSトランジスタP7がターンOFFする前に、出力端子OUTの電位が3[V]+Vt hよりも高くなったときには、PMOSトランジスタP6がターンONし、このP6による順方向ダイオードにより、出力端子OUTの電位を3[V]+Vt hにクランプする。

【0032】上記のように、イネーブル入力端子EB ="L"レベルであり、入出力端子YPADが5 [V]であるとき、PMOSトランジスタP2およびP3がOFFしていることにより、PMOSトランジスタP1のドレイン電極(ノードS)はハイインピーダンスとなっており、ノードSおよびPMOSトランジスタP1のバルクを通して、入出力端子YPADから内部電源VDDにリーク電流が流れてしまうことはない。またフローティングバルクBは内部電源VDDには接続していないので、PMOSトランジスタP2のドレイン電極、および

P4、P5の各ソース電極を介してフローティングバルクBから内部電源VDDにリーク電流が流れてしまうこともない。またインバータINV2の入力端子は、インバータINV2内部の図示しないMOSトランジスタのゲート電極に接続されており、ハイインピーダンスとなっている。またNMOSトランシスタN1のドレインとバルクとは逆バイアスされており、N1のドレイン電極もハイインピーダンスとなっている。従って、出力端子OUTから接地電源GNDにリーク電流が流れてしまうこともない。

【0033】次に、イネーブル入力端子EBが"H"レベル(3 [V])に設定されているときの動作を説明する。このとき、図1の入出力回路は出力回路として動作し、入力端子INに入力された信号を入出力端子YPADから出力する。

【0034】入力端子INが"L"レベル(0[V]) のときは、NANDゲート1の出力すなわちノードPG は"H"レベルとなるので、PMOSトランジスタP1 はOFFしている。またNORゲート2の出力すなわちノードNGは"H"レベルとなるので、NMOSトランジスタN1はONしている。従って入出力端子YPAD は"L"レベル(0[V])となっている。

【0035】入出力端子YPADが"L"レベルなの で、NMOSトランジスタN7はONしており、これに より出力端子〇UTは"し"レベルとなっている。イン パータINV2の出力すなわちノードOUTNは"H" レベル(3 [V]) となるので、NMOSトランジスタ N3はONしている。またノードNGが"H"レベルな ので、インバータINV3の出力は"L"レベルであ り、従ってNMOSトランジスタN4はOFFしてい る。またイネーブル入力端子EBが"H"レベルなの で、NMOSトランジスタN5のソース電極すなわちノ ードG2の電位は3[V]-Vthとなり、またNMO SトランジスタN9のソース電極すなわちノードG1の 電位は3[V]-Vthとなっている。ノードG1およ び内部電源VDDの電位が入出力端子YPADの電位よ りも高いので、PMOSトランジスタP2、P4、P 5、P7はOFFしている。ノードSの電位は3 [V] -Vth以下となっており、PMOSトランジスタP3 もOFFしている。

【0036】次に入力端子INを"L"レベルから"H"レベルに変化させると、NANDゲート1の出力すなわちはノードPGは"H"レベルから"L"レベルに変化しするので、PMOSトランジスタP1はターンONし、NMOSトランジスタN5もターンONする。またNORゲート2の出力は"H"から"L"に変化し、ノードNGは"L"レベルとなり、NMOSトランジスタN1はターンOFFする。またノードNGが"L"レベルとなると、インバータINV3の出力が、"L"レベルから"H"レベルに変化し、これによりNMOSト

ランジスタN4がターンONする。MOSトランジスタN4、N5のターンONにより、ノードG2は"L"レベルとなり、これによりNMOSトランジスタN9がターンONし、ノードG1も"L"レベルとなる。

18

ベルとなり、これによりNMOSトランジスタN9がターンONし、ノードG1も"L"レベルとなる。
【0037】またPMOSトランジスタP1のターンONにより、ノードSが内部電源VDDレベル(3
[V])となる。ノードG1は"L"レベルなので、PMOSトランジスタP2およびP3はターンONする。PMOSトランジスタP2のターンONにより、入出力(3 [V])に上昇する。またPMOSトランジスタP3のターンONにより、フローティングバルクBの電位は内部電源VDDレベル(3 [V])に上昇する。PMOSトランジスタP3は、フローティングバルクBの電位を3 [V]まで確実に上昇させ、PMOSトランジスタP3により安定させるために設けられたもので

【0038】入出力端子YPADがVthに上昇すると、PMOSトランジスタP7がターンONし、入出力端子YPADが内部電源VDDレベル(3 [V])に上昇すると、出力端子OUTも内部電源VDDレベル(3 [V])に上昇し、これによりNMOSトランジスタN7はターンOFFする。またインバータINV2の出力すなわちノードOUTNは"L"レベルに変化するので、NMOSトランジスタN3はターンOFFする。しかし、ノードG1は"L"レベルのままである。

【0039】このように第1の実施形態によれば、入出 力端子YPADに5 [V] が入力されたとき、NMOS トランジスタN7だけでは内部電源VDDレベル (3) [V]) まで上昇せず、出力端子OUTに接続される内 部回路におけるVIHマージンが不足するという問題 を、フローティングパルクBに形成したPMOSトラン ジスタP7により、出力端子OUTを内部電源VDDま で上昇させることができ、内部入力回路のVIHマージ ンを充分に満たすことができる。また、入出力端子YP ADに内部電源VDD以上の電圧が入力されても、PM OSトランジスタP7がOFFするので、出力端子OU Tは内部電源VDDレベルとなる。また、図2(c)に 示すように、入出力波形(入出力端子YPAD)の立ち 上がり時以外においては、入出力端子YPADから内部 40 電源VDDへの電流の流れ込みは発生しない。

【0040】尚、電源電圧=3Vに対して、外部入力=5Vで説明したが、他の条件でも構わない。内部電源電圧よりも外部電源電圧が高い条件に対して有効である。 【0041】第2の実施形態

図3は本発明の第2の実施形態の出力回路を示す回路図である。図3に示す出力回路は、LSIチップに内蔵されており、入力端子INと、イネーブル入力端子EBと、出力端子OUTと、2入力のNANDゲート1と、2入力のNORゲート2と、PMOSトランジスタP1

50

~P5と、NMOSトランジスタN1およびN3と、インバータINV1およびINV2とを有する。このLSIチップの内部電源VDDは例えば3[V]である。出力端子OUTは、このLSIチップの外部に信号電圧を出力するための端子である。この出力端子OUTには、LSIチップの外部に設けられたプルアップ抵抗R1の一端が接続されている。このプルアップ抵抗R1は、その他端が例えば5[V]の外部電源VCCに接続されおり、出力端子OUTを例えば5[V]にプルアップするための抵抗である。

19

【0042】NANDゲート1は、その第1入力端子が入力端子INに接続され、その第2入力端子がイネーブル入力端子EBに接続され、その出力端子が内部ノードPGに接続されている。NORゲート2は、その第1入力端子が入力端子INに接続され、その第2入力端子がインバータINV1を介してイネーブル入力端子EBに接続され、その出力端子が内部ノードNGに接続されている。インバータINV2は、その入力端子が出力端子OUTに接続され、その出力端子が内部ノードOUTNに接続されている。

【0043】NMOSトランジスタN1は、そのゲート 電極がノードNGに接続され、そのドレイン電極が出力 端子OUTに接続され、そのソース電極が接地電源GN Dに接続されている。NMOSトランジスタN3は、そ のゲート電極がノードOUTNに接続され、そのドレイ ン電極が内部ノードGに接続され、そのソース電極が接 地電源GNDに接続されている。

【0044】PMOSトランジスタP1は、そのゲート電極がノードPGに接続され、そのソース電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極は内部ノードSに接続されている。PMOSトランジスタP2は、そのゲート電極がノードGに接続され、そのドレイン電極が出力端子OUTに接続され、そのソース電極がノードGに接続され、そのソース電極がノードSに接続されている。PMOSトランジスタP3は、そのゲート電極がノードGに接続され、そのソース電極がメードのUTNに接続され、そのソース電極が出力端子OUTに接続されている。PMOSトランジスタP4は、そのゲート電極がノードGに接続され、そのソース電極が出力端子OUTに接続されている。PMOSトランジスタP5は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのソース電極が出力端子OUTに接続されている。

【0045】PMOSトランジスタP2、P3、P4、P5は共通のバルク(基板)Bに形成されている。このフローティングバルクBは、内部電源VDDおよび接地電源GNDのいずれにも接続されていないNウエルである。PMOSトランジスタP3およびP5のドレイン電極はフローティングバルクBに接続されている。PMOSトランジスタP1のバルクは内部電源VDDに接続されており、NMOSトランジスタN1およびN3のバル

クは接地電源GNDに接続されている。

【0046】出力端子OUTには、PMOSトランジスタP2のドレイン電極と、P4、P5の各ソース電極と、NMOSトランジスタN1のドレイン電極と、インバータINV2の入力端子とが接続されている。ノードGには、PMOSトランジスタP2、P3の各ゲート電極と、P4のドレイン電極と、NMOSトランジスタN3のドレイン電極とが接続されている。ノードSには、PMOSトランジスタP1のドレイン電極と、P2、P3の各ソース電極とが接続されている。ノードOUTNには、インバータINV2の出力端子と、PMOSトランジスタP4、NMOSトランジスタN3の各ゲート電極とが接続されている。

20

【0047】次に、図3に示した出力回路の動作を説明 する。図4は図3に示す出力回路の動作タイミング図で あり、(a)は各部の電圧波形、(b)は消費電流波形 を示す。まず、イネーブル入力端子EBが"L"レベル  $(0 \ [V])$  に設定されているときの動作を説明する。 NANDゲート1の出力すなわちノードPGは" H"レ 20 ベル (3 [V]) となるので、PMOSトランジスタP 1はOFFしている。またインパータINV1の出力 は"H"レベルとなり、NORゲート2の出力すなわち ノードNGは"L"レベルとなるので、NMOSトラン ジスタN1はOFFしている。このようにイネーブル入 力端子EBが"L"レベルのときは、PMOSトランジ スタP1、NMOSトランジスタN1はともにOFFし ており、入力端子 I Nのレベルにかかわらず、出力端子 OUTは高インピーダンスとなる。このとき、出力端子 OUTは、外部のプルアップ抵抗R1により、外部電源 VCCレベル(5 [V])となる。 30

【0048】出力端子OUTが5 [V] なので、インバータINV2の出力すなわちノードOUTNは"L"レベルとなっており、NMOSトランジスタN3はOFFしている。ノードOUTNは"L"レベルであり、出力端子OUTが5 [V] なので、PMOSトランジスタP4はONしており、ノードGの電位は出力端子OUTと同じ5 [V] になっている。また出力端子OUTが5[V]なので、そのゲート電極が内部電源VDD(3[V])に接続されているPMOSトランジスタP5は40 ONしており、これによりフローティングバルクBの電位は出力端子OUTと同じ5 [V]になっている。

【0049】出力端子OUTおよびノードGの電位がともに5 [V] なので、PMOSトランジスタP2はOFFしている。また出力端子OUTおよびフローティングバルクBの電位がともに5 [V] なので、PMOSトランジスタP3もOFFしている。

【0050】PMOSトランジスタP2およびP3がO FFしていることにより、PMOSトランジスタP1の ドレイン電極(ノードS)はハイインピーダンスとなっ 50 ており、ノードSおよびPMOSトランジスタP1のパ ルクを通して、出力端子OUTから内部電源VDDにリーク電流が流れてしまうことはない。またフローティングバルクBは内部電源VDDには接続していないので、PMOSトランジスタP2のドレイン、およびP4、P5のソースを介してフローティングバルクBから内部電源VDDにリーク電流が流れてしまうこともない。またインバータINV2の入力端子は、インバータINV2内部の図示しないMOSトランジスタのゲート電極に表別のではいからとはでいる。またNMOSトランシスタN1のドレインとバルクとは逆バイアスされており、N1のドレイン電極もハイインピーダンスとなっている。従って、出力端子OUTから接地電源GNDにリーク電流が流れてしまうこともない。

【0051】次に、イネーブル入力端子EBが"H"レベル(3 [V])に設定されているとき動作を説明する。入力端子INが"L"レベル(0 [V])のとき、NANDゲート1の出力すなわちノードPGは"H"レベル(3 [V])となり、PMOSトランジスタP1はOFFしている。NORゲート2の出力すなわちノードNGは"H"レベルとなり、NMOSトランジスタN1はONしている。従って、出力端子OUTは"L"レベル(0 [V])となっている。

【0052】インバータINV2の出力すなわちノードOUTNは"H"レベル(3 [V])である。ノードOUTNが"H"レベル(3 [V])である。ノードOUTNが"H"レベルなので、NMOSトランジスタN3はONしており、またPMOSトランジスタP4はOFFしている。従ってノードGは"L"レベルとなっている。出力端子OUTとノードGとがともに"L"レベルなので、PMOSトランジスタP2はOFFしている。ノードSの電位はVth以下になっており、PMOSトランジスタP3はOFFしている(出力端子OUTが"L"レベルとなったとき、ノードSの電位がVthより高い場合には、PMOSトランジスタP2、P3がONしてノードSの電位をVthまで降下させ、そのあとP2、P3がターンOFFする)。また出力端子OUTが"L"レベルなので、PMOSトランジスタP5もOFFしている。

【0053】次に入力端子INを"L"レベルから"H"レベルへ変化させると、NANDゲート1の出力すなわちノードPGは"H"レベルから"L"レベルに変化し、PMOSトランジスタP1はターンONする。またNORゲート2の出力すなわちノードNGは"H"から"L"に変化し、NMOSトランジスタN1はターンOFFする。

【0054】PMOSトランジスタP1がターンONすると、ノードSが内部電源VDDレベル(3 [V])となる。ノードGは"L"レベルなので、PMOSトランジスタP2およびP3はターンONする。PMOSトランジスタP2のターンONにより、出力端子OUTは"レベルから内部電源VDDレベル(3 [V])に上

昇する。またPMOSトランジスタP3のターンONにより、フローティングバルクBの電位は内部電源VDDレベル(3 [V])に上昇する。PMOSトランジスタP3は、フローティングバルクBの電位を3 [V]まで確実に上昇させ、PMOSトランジスタP2の動作をより安定させるために設けられたものである。

【0055】出力端子OUTが内部電源VDDレベル (3 [V])に上昇すると、インパータINV2の出力 すなわちノードOUTNは"L"レベルに変化し、これ によりNMOSトランジスタN3がターンOFFし、ま たPMOSトランジスタP4がターンONする。PMO SトランジスタP4のターンONにより、ノードGの電 位は、"L"レベルから出力端子OUTと同じ電位に上 昇する。ノードGと出力端子OUTとが同じ電位になっ たことにより、PMOSトランジスタP2およびP3は ターンOFFする。

【0056】このあと、プルアップ抵抗R1により、出力端子OUTは外部電源VCCレベル(5[V])まで上昇する。出力端子OUTが5[V]となると、ノードGも5[V]となる。またPMOSトランジスタP5がターンONし、これによりフローティングバルOBもS[V]となる。

【0057】イネーブル入力端子EB="H"レベルで あり、入力端子 I N="H"であるときには、上記イネ ープル入力端子EB="L"レベルのときと同様に、P MOSトランジスタP2およびP3がOFFしているこ とにより、PMOSトランジスタP1のドレイン電極 (ノードS) はハイインピーダンスとなっており、ノー ドSおよびPMOSトランジスタP1のバルクを通し て、出力端子OUTから内部電源VDDにリーク電流が 流れてしまうことはない。またフローティングバルク B は内部電源VDDには接続していないので、PMOSト ランジスタ**P2のドレイン、およびP4、P5のソー**ス を介してフローティングパルクBから内部電源VDDに リーク電流が流れてしまうこともない。またインパータ INV2の入力端子は、インバータINV2内部の図示 しないMOSトランジスタのゲート電極に接続されてお り、ハイインピーダンスとなっている。またNMOSト ランシスタN1のドレインとバルクとは逆パイアスされ ており、N1のドレイン電極もハイインピーダンスとな っている。従って、出力端子OUTから接地電源GND にリーク電流が流れてしまうこともない。

【0058】このように第2の実施形態によれば、出力波形立ち上がり時において、内部電源電圧VDDレベルまでは外部のプルアップ抵抗R1に依存せずに、高速動作が可能となる。その後、抵抗R1を介して外部電源VCCレベル(5 [V])となるが出力波形の立ち上がり時以外においては、内部電源電圧VDDへの電流の流れ込みは発生しない。そのため、5 [V] で動作する外部回路にインターフェースするとき、外部回路のしきい値

50

電圧VTH(2.5 [V])までは高速に動作でき、外部回路におけるVIH(3.5 [V])も保証できるようになる。また、プルアップ抵抗R1の値が大きい場合でも、上記のVTHまでは高速動作することができるため、低消費電力化が可能となる。

【0059】尚、電源電圧=3Vに対して、外部入力=5Vで説明したが、他の条件でも構わない。内部電源電圧よりも外部電源電圧が高い条件に対して有効である。

【0060】第3の実施形態

図5は本発明の第3の実施形態の出力回路を示す回路図である。図5に示す出力回路は、LSIチップに内蔵されており、入力端子INと、イネーブル入力端子EBと、出力端子OUTと、2入力のNANDゲート1と、2入力のNORゲート2と、PMOSトランジスタP1~P5と、NMOSトランジスタN1およびN3と、インバータINV1およびINV2と、遅延回路DL1とを有する。出力端子OUTにはプルアップ抵抗R1が接続されている。図5において、図3と共通する部分については同一符号を付してある。

【0061】図5に示す出力回路は、図3の出力回路において、ノードOUTNとPMOSトランジスタP4のゲート電極との間に、遅延回路DL1を設けたものである。PMOSトランジスタP4のゲート電極はノードOUTNには接続していない。P4のゲート電極に接続するノードをOUTNDとする。

【0062】遅延回路DL1は、その入力端子がノード OUTNに接続され、その出力端子がノードOUTND に接続されており、ノードOUTNが"H"レベルから"L"レベルに変化したときに、設定された遅延時間 が経過してからノードOUTNDを"H"レベルから"L"レベルに変化させる。

【0063】次に図5に示した出力回路の動作を説明する。図6は図5に示す出力回路の動作タイミング図であり、(a)は各部の電圧波形、(b)は消費電流波形を示す。図5に示す出力回路の動作は、図3に示した第2の実施形態の出力回路の動作とほぼ同じである。ただし、以下に説明する動作、すなわちイネーブル入力端子EBが"H"レベルに設定されており、入力端子INが"L"レベルから"H"レベルに変化するときの動作が図3の出力回路とは異なる。

【0.0.6.4】入力端子 I.Nが" I." レベルから" H." レベルに変化し、出力端子 O.U.Tが内部電源 V.D.Dレベル (3.[V]) に上昇すると、インバータ I.N.V.2 の出力 すなわちノード O.U.T.Nは" H." レベルから" I." レベルに変化し、I.T.D.V.T.D.

【0065】遅延回路DL1は、ノードOUTNが" L"レベルに変化してから、所定時間を経過してから、 ノードOUTNDを"H"レベルから"L"レベルに変 化させる。従って、PMOSトランジスタP4は、NM OSトランジスタN3のターンOFFと同時にターンONせず、ノードOUTNの"L"レベルへの変化から、所定時間を経過してからターンONする。すなわち、上記第2の実施形態よりも、PMOSトランジスタP4がターンONするタイミングが遅くなり、従ってPMOSトランジスタP2、P3がターンOFFするタイミングを遅くなる。

【0066】このように第3の実施形態によれば、第2の実施形態の効果に加え、ノードOUTNとPMOSトランジスタP4のゲート電極との間に遅延回路DL1を設けることにより、出力波形立ち上がり時において、PMOSトランジスタP4がOFFしている時間を確実に長くすることができ、調節も容易になる。これによりPMOSトランジスタP2がONしている時間を長くすることができるので、内部電源VDDまでの高速動作が可能となる。

【0067】第4の実施形態

図7は本発明の第4の実施形態の出力回路を示す回路図である。図7に示す出力回路は、LSIチップに内蔵されており、入力端子INと、イネーブル入力端子EBと、出力端子OUTと、2入力のNANDゲート1と、2入力のNORゲート2と、PMOSトランジスタP1~P7と、NMOSトランジスタN1~N4、N7と、インパータINV1およびINV2とを有する。出力端子OUTにはプルアップ抵抗R1が接続されている。図7において、図3と共通する部分については同一符号を付してある。

【0068】図7に示す出力回路は、図3の出力回路において、NMOSトランジスタN2、N4、N7と、P30 MOSトランジスタP6、P7とを設け、PMOSトランジスタP4のゲートを、ノードOUTNではなく、NMOSトランジスタN3のドレイン電極に接続したものである。NMOSトランジスタN3のドレイン電極とPMOSトランジスタP4のゲート電極とに接続するノードをSP4とする。

【0069】NMOSトランジスタN2は、そのゲート 電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極が 出力端子OUTに接続され、そのソース電極がNMOSトランジスタN1のドレイン電極に接続されている。N MOSトランジスタN1のドレイン電極は出力端子OU Tには接続されていない。NMOSトランジスタN4は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極がノードGに接続され、そのソース電極がノードSP4に接続されている。NMOSトランジスタN3のドレイン電極はノードGには接続されていない。【0070】NMOSトランジスタN7およびPMOSトランジスタP7は、ともに出力端子OUTとインバータINV2の入力端子との間に設けられている。インバータINV2の入力端子は、出力端子OUTには接続されていない。INV2の入力端子に接続するノードをY

٠. -

とする。PMOSトランジスタP6は、そのゲート電極およびソース電極が内部電源VDDに接続され、ドレイン電極がノードYに接続されている。このダイオード接続されたPMOSトランジスタP6は、ノードYが内部電源VDDより低電位である限りOFFしたままである。

【0071】NMOSトランジスタN7は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、その第1電極(ドレイン電極またはソース電極)が出力端子OUTに接続され、その第2電極(ソース電極またはドレイン電極)がノードYに接続されている。PMOSトランジスタP7は、そのゲート電極がノードGに接続され、その第1電極(ドレイン電極またはソース電極)がノードYに接続され、その第2電極(ソース電極またはドレイン電極)が出力端子OUTに接続されている。

【0072】出力端子OUTには、PMOSトランジスタP2のドレイン電極と、P4、P5の各ソース電極と、P7の第2電極と、NMOSトランジスタN2のドレイン電極と、N7の第1電極とが接続されている。ノードGには、PMOSトランジスタP2、P3、P7の各ゲート電極と、P4のドレイン電極と、NMOSトランジスタN4のドレイン電極とが接続されている。ノードOUTNには、インバータINV2の出力端子と、NMOSトランジスタN3のゲート電極とが接続されている。

【0073】次に、図7に示す出力回路の動作を説明す る。図8は図7に示す出力回路の動作タイミング図であ り、(a)は各部の電圧波形、(b)は消費電流波形を 示す。まず、イネーブル入力端子EBが"L"レベル  $(0\ [V])$  に設定されているときの動作を説明する。 NANDゲート1の出力すなわちノードPGは"H"レ ベル (3 [V]) となるので、PMOSトランジスタP 1はOFFしている。またNORゲート2の出力すなわ ちノードNGは"L"レベルとなるので、NMOSトラ ンジスタN1はOFFしている。このようにイネーブル 入力端子EBが"L"レベルのとき、PMOSトランジ **スタP1、NMOSトランジスタN1はともにOFFし** ており、入力端子 I Nのレベルにかかわらず、入出力端 子YPADは髙インピーダンスとなる。このとき、出力 端子OUTは、外部のプルアップ抵抗R1により、外部 電源VCCレベル(5 [V])となる。出力端子OUT が5 [V] であり、ノードSP4の電位はVDD-V t hより高くなることはないので、PMOSトランジスタ P4はONしており、ノードGの電位は出力端子OUT と同じ5 [V] になっている。また出力端子OUTが5 [V] なので、PMOSトランジスタP5はONしてお り、これによりフローティングバルクBの電位は出力端 子〇UTと同じ5 [V] になっている。出力端子〇UT およびノードGの電位がともに5 [V] なので、PMO SトランジスタP2はOFFしている。また出力端子O UTおよびフローティングバルクBの電位がともに5 [V] なので、PMOSトランジスタP3もOFFしている。

26

【0074】出力端子OUTおよびノードGが5 [V] なので、PMOSトランジスタP7およびNMOSトランジスタN7はともにOFFしている。出力端子OUTが5 [V] に上昇するとき、PMOSトランジスタP7はノードYを3 [V] まで上昇させてからOFFするので、ノードYは3 [V] である。従ってインバータIN V2の出力すなわちノードOUTNは"L"レベルとなっており、NMOSトランジスタN3はOFFしている。ノードGの電位が5 [V] なので、NMOSトランジスタN4のソース電極すなわちノードSP4の電位は5 [V] -2Vthとなっている。

【0075】上記のように、イネーブル入力端子EB が"し"レベルに設定されているとき、PMOSトラン ジスタP2およびP3がOFFしていることにより、P MOSトランジスタP1のドレイン電極 (ノードS) は ハイインピーダンスとなっており、ノードSおよびPM OSトランジスタP1のバルクを通して、入出力端子Y PADから内部電源VDDにリーク電流が流れてしまう ことはない。またフローティングバルクBは内部電源V **DDには接続していないので、PMOSトランジスタP** 2のドレイン電極、およびP4、P5の各ソース電極を 介してフローティングバルクBから内部電源VDDにリ ーク電流が流れてしまうこともない。またインバータ I NV2の入力端子は、インパータINV2内部の図示し ないMOSトランジスタのゲート電極に接続されてお り、ハイインピーダンスとなっている。またNMOSト ランシスタN1のドレインとバルクとは逆パイアスされ ており、N1のドレイン電極もハイインピーダンスとな っている。従って、出力端子OUTから接地電源GND にリーク電流が流れてしまうこともない。

【0076】次に、イネーブル入力端子EBが"H"レベル(3 [V])に設定されているときの動作を説明する。入力端子INが"L"レベル(0 [V])のときは、NANDゲート1の出力すなわちノードPGは"H"レベルとなるので、PMOSトランジスタP1はOFFしている。またNORゲート2の出力すなわちノードNGは"H"レベルとなるので、NMOSトランジスタN1はONしている。従って出力端子OUTは"L"レベル(0 [V])となっている。

【0077】出力端子OUTが"L"レベルなので、NMOSトランジスタN7はONしており、これによりノードYは"L"レベルとなっている。インバータINV2の出力すなわちノードOUTNは"H"レベル(3[V])となるので、NMOSトランジスタN3はONしており、またN4もONしている。NMOSトランジスタN3およびN4がONしているので、ノードGおよびノードSP4はともに"L"レベルとなっている。ノ

ードGと出力端子OUTがともに"L"レベル(0 [V])なので、PMOSトランジスタP2、P4、P-5、P7はOFFしている。またノードSの電位はVth以下となっており、PMOSトランジスタP3もOFFしている。

【0079】PMOSトランジスタP1のターンONにより、ノードSが内部電源VDDレベル(3 [V])となる。ノードGは"L"レベルなので、PMOSトランジスタP2およびP3はターンONする。PMOSトランジスタP2のターンONにより、出力端子OUTは"L"レベルから内部電源VDDレベル(3 [V])に上昇する。またPMOSトランジスタP3のターンONにより、フローティングバルクBの電位は内部電源VDDレベル(3 [V])に上昇する。

【0080】出力端子OUTがVthに上昇すると、PMOSトランジスタP4、P7がターンONし、ノードYの電位は、出力端子OUTと同じになる。ノードGはNMOSトランジスタN3がOFFするまで"L"レベルにクランプされる。さらに出力端子OUTおよびノードGが内部電源レベル(3 [V])に上昇すると、インバータINV2の出力すなわちノードOUTNが"L"レベルに変化するので、NMOSトランジスタN3はターンOFFする。NMOSトランジスタN3のターンOFFにより、ノードGの電位は出力端子OUTと同じ3 [V]となり、これにより、PMOSトランジスタP7がターンOFFする。また出力端子ノードSP4の電位は3 [V]ーVthとなる。ノードGとノードSの電位が同じになるので、PMOSトランジスタP2、P3がターンOFFする。

【0081】このあと、プルアップ抵抗R1により、出力端子OUTは外部電源VCCレベル(5 [V])まで上昇する。PMOSトランジスタP4はONしたままである。出力端子OUTが3 [V] + Vthに上昇すると、PMOSトランジスタP5がターンONにより、フローティングバルクBの電位は出力端子OUTと同じ電位となる。そして、出力端子OUTが最終的に外部電源とVCCレベル(5 [V])となったとき、ノーティングバルクBも5 [V]となる。もしも、PMOSトランジスタP7がターンOFFするる前に、出力端子OUTの電位が3 [V] + Vthよりもたときには、PMOSトランジスタP6がターンONして、出力端子OUTの電位を3 [V] + Vthにクラン

プする。

【0082】このように、イネーブル入力端子EBが"H"レベルであり、入力端子INが"H"であるときにも、上記のイネーブル入力端子EBが"L"レベルのときと同様に、PMOSトランジスタP2およびP3がOFFしていることにより、ノードSおよびPMOSトランジスタP1のバルクを通して内部電源VDDにリーク電流が流れてしまうことはない。またフローティングバルクBは内部電源VDDには接続していないので、フローティングバルクBから内部電源VDDにリーク電流が流れてしまうこともない。またインバータINV2の入力端子およびNMOSトランシスタN1のドレインから接地電源GNDにリーク電流が流れてしまうこともない。

【0083】このように第4の実施形態によれば、上記第2の実施形態の効果に加え、PMOSトランジスタP4、P7、NMOSトランジスタN2、N4、N7により、1つのMOSトランジスタのソース/ドレイン間、ゲート/ソース間、およびゲート/ドレイン間に520 [V] がかかることがないので、耐圧の弱いプロセスにも対応することができる。

【0084】第5の実施形態

図9は本発明の第5の実施形態の出力回路を示す回路図である。図9に示す出力回路は、LSIチップに内蔵されており、入力端子INと、イネーブル入力端子EBと、セレクト入力端子SELと、出力端子OUTと、2入力のNANDゲート1と、2入力のNORゲート2および3と、PMOSトランジスタP1~P8と、NMOSトランジスタN1~N8と、インパータINV1およびINV4とを有する。図9に示す出力回路は、出力端子OUTにプルアップ抵抗R1が接続されている場合と、そうでない場合のいずれにも対応することができる。図9において、図5と共通する部分については同一符号を付してある。

【0085】図9に示す出力回路は、図5の出力回路において、NMOSトランジスタN5、N6、N8と、PMOSトランジスタP8と、NANDゲート2と、インバータINV4とを設け、インパータINV2を取り外したものである。インパータINV4は、その入力端子がウト入力端子SELに接続され、その出力端子が内部ノードISに接続されている。NORゲート3は、その第1入力端子がノードISに接続され、その第2入力端子がノードYに接続され、その出力端子がノードOUTNに接続されている。

【0086】NMOSトランジスタN5は、そのゲート 電極がノードISに接続され、そのドレイン電極がノー ドPGに接続されている。NMOSトランジスタN6 は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、その ドレイン電極がNMOSトランジスタN5のソース電極 50 に接続され、そのソース電極がノードGに接続されてい

る。

[0087] NMOSトランジスタN8は、そのゲート **電極がセレクト入力端子SELに接続され、その第1電** 極(ドレイン電極またはソース電極)がノードSP4に 接続され、その第2電極(ソース電極またはドレイン電 極)は内部ノードSNに接続されている。NMOSトラ ンジスタN3のドレイン電極およびNMOSトランジス タN4のソース電極は、ノードSP4に接続せずに、ノ ードSNに接続されている。PMOSトランジスタ**P**8 は、そのゲート電極がセレクト入力端子SELに接続さ れ、そのドレイン電極がノードSP4に接続され、その ソース電極は内部電源VDDに接続されている。

【0088】図10はLSI40 (3 [V] の内部電源 VDD) に内蔵された第5の実施形態の出力回路42 (図9参照)と、外部電源VCCで動作する外部回路4 3との接続例を示す図であり、(a)は外部電源VCC が3[V]のときの接続例を示し、(b)は外部電源 $\,$ V C C が 5 [V] のときの接続例を示す。図 1 0 (b) に おいては、出力回路42の出力端子OUTに、一端が外 部電源VCCに接続されたプルアップ抵抗R1の他端を 接続する。

【0089】次に、図9に示す出力回路の動作を説明す る。図11は図9に示す出力回路の動作タイミング図で あり、 (a) はセレクト入力端子SELが"L"レベル に設定されているときの各部の電圧波形、(b)はセレ クト入力端子SELが"H"レベルに設定されていると きの各部の電圧波形を示す。イネーブル入力端子**EB** は"H"レベル(3 [V]) に設定されているものとす

【0090】まず、セレクト入力端子SELが"L"レ ベルに設定されているときの動作を説明する。このとき 図9に示す出力回路(図10における出力回路42) は、図10(a)のように接続される。入力端子IN が"し"レベルのとき、NANDゲート1の出力すなわ ちノードPGは"H"レベルとなるので、PMOSトラ ンジスタP1はOFFしている。またNORゲート2の 出力すなわちノードNGは"H"レベルとなるので、N MOSトランジスタN1はONしている。従って出力端 子OUTは"L"レベル(0 [V])となっている。

【0091】出力端子OUTが"L"レベルなので、N MOSトランジスタN7はONしており、これによりノ ードYは"L"レベルとなっている。しかし、ノード I Sは" H"レベルであるため、NOR3の出力すなわち ノードOUTNは、ノードYのレベルにかかわらず" L"レベルとなり、NMOSトランジスタN3はOFF している。またノードISが"H"レベルなので、NM OSトランジスタN5もONしている。NMOSトラン ジスタN4およびN6がONしており、ノードPGが" H"レベルなので、ノードGの電位はVDD-Vthと なっている。セレクト入力端子SELが"し"レベルな 50 MOSトランジスタN8はONしており、またPMOS

ので、NMOSトランジスタN8はOFFしており、ま たPMOSトランジスタP8はONしている。従ってノ ードSP4は内部電源VDDレベル(3 [V])となっ ている。ノードGがVDD-Vthであり、出力端子O UTが" L" レベル (0 [V]) であり、ノードSP4 が3 [V] なので、PMOSトランジスタP2、P4、

30

P5、P7はOFFしている。 【0092】次に入力端子 I Nを"L"レベルから" H"レベルに変化させると、NANDゲート1の出力す 10 なわちノードPGは"H"レベルから"L"レベルに変 化するので、PMOSトランジスタP1はターンONす る。またNORゲート2の出力すなわちノードNGは" H"から"L"に変化するので、NMOSトランジスタ N1はターンOFFする。

【0093】PMOSトランジスタP1のターンONに より、ノードSが内部電源VDDレベル(3 [V])と なる。ノードPGが"L"レベルとなるので、ノードG はVDD-Vthから"L"レベル(0 [V])に変化 する。従ってPMOSトランジスタP2およびP3はタ ーンONする。PMOSトランジスタP2のターンON 20 により、出力端子〇UTは"L"レベルから内部電源V DDレベル(3 [V]) に上昇する。またPMOSトラ ンジスタP3のターンONにより、フローティングバル クBの電位は内部電源VDDレベル(3[V])に上昇

【0094】出力端子〇UTがVthに上昇したとき、 PMOSトランジスタP7がターンONし、ノードYの 電位は、出力端子OUTと同じになる。PMOSトラン ジスタP4はOFFのままである。

【0095】次に、セレクト入力端子SELが"H"レ ベルに設定されているときの動作を説明する。このとき 図9に示す出力回路(図10における出力回路42) は、図10(b)のように接続される。入力端子IN が" L"レベル(0 [V])のときは、NANDゲート 1の出力すなわちノードPGは"H"レベルとなるの で、PMOSトランジスタP1はOFFしている。また NORゲート2の出力すなわちノードNGは"H"レベ ルとなるので、NMOSトランジスタN1はONしてい る。従って出力端子OUTは"L"レベル(0[V]) 40 となっている。

【0096】出力端子OUTが"L"レベルなので、N MOSトランジスタN7はONしており、これによりノ ードYは"L"レベルとなっている。ノードISが" L"レベルとなるので、NOR3の出力すなわちノード OUTNは"H"レベルとなり、NMOSトランジスタ N3はONしている。またノードISが"L"レベルな ので、NMOSトランジスタN5は常にOFFしてい る。従ってノードGの電位は"L"レベルとなってい る。セレクト入力端子SELが"H"レベルなので、N

31

トランジスタP8はOFFしている。従ってノードSP 4は"L"レベルとなっている。ノードG、ノードSP 4、および出力端子OUTがともに"L"レベル(0 [V]) なので、PMOSトランジスタP2、<math>P4、P5、P7はOFFしている。

【0097】次に入力端子 I Nを"L"レベルから" H"レベルに変化させると、NANDゲート1の出力す なわちはノードPGは"H"レベルから"L"レベルに 変化しするので、PMOSトランジスタP1はターンO Nする。またNORゲート2の出力は"H"から"L" に変化し、ノードNGは"L"レベルとなり、NMOS トランジスタN1はターンOFFする。

【0098】PMOSトランジスタP1のターンONに より、ノードSが内部電源VDDレベル(3[V])と なる。ノードGは"L"レベルなので、PMOSトラン ジスタP2およびP3はターンONする。PMOSトラ ンジスタP2のターンONにより、出力端子OUTは" L"レベルから内部電源VDDレベル(3 [V]) に上 昇する。またPMOSトランジスタP3のターンONに より、フローティングバルクBの電位は内部電源VDD レベル (3 [V]) に上昇する。

【0 0 9 9】出力端子OUTがV t h に上昇したとき、 PMOSトランジスタP4、P7がターンONし、これ によりノードGおよびノードYの電位は出力端子OUT と同じになる。出力端子OUTおよびノードGが内部電 源レベル (3 [V]) に上昇しても、PMOSトランジ スタP4はONしたままである。ノードGの電位が出力 端子OUTと同じになると、PMOSトランジスタP7 がターンOFFする。またノードGが内部電源レベル (3 [V]) に上昇すると、ノードGとノードSの電位 が同じになるので、PMOSトランジスタP2、P3が ターンOFFする。

【0100】このあと、プルアップ抵抗R1により、出 カ端子OUTは外部電源VCCレベル(5 [V])まで 上昇する。PMOSトランジスタP4はONしたままで ある。出力端子OUTが3 [V] + V t h に上昇する と、PMOSトランジスタP5がターンONする。PM OSトランジスタP5のターンONにより、フローティ ングバルクBの電位は出力端子OUTと同じ電位とな る。そして、出力端子OUTが最終的に外部電源電圧V CCレベル(5 [V])となったとき、ノードGおよび フローティングバルクBも5 [V] となる。

【0101】このように第5の実施形態によれば、セレ クト入力端子SELにより、外部電源VCC(5

[V]) までの出力振幅が可能となり、また外部に設け . たプルアップ抵抗R1に頼らず内部電源電圧VDDレベ ル(3 [V])までの出力振幅が可能となる。すなわ ち、図10に示すように3 [V] 動作の外部回路と5 [V] 動作の外部回路のいずれにも同じLSIチップで インターフェースすることができる。

【0102】尚、セレクト入力端子SELの電圧レベル 設定は、LSI外部からSEL信号を入力するようにし ても良く、またLSI内部でSEL信号を生成するよう にしても良い。

【0103】第6の実施形態

図12は本発明の第6の実施形態の入力回路を示す回路 図である。図12に示す入力回路は、LSIチップに内 蔵されており、入力端子INと、出力端子OUTと、P MOSトランジスタP31、P32と、NMOSトラン 10 ジスタN31~N37と、インパータINV31、IN V32と、抵抗R31とを有する。このLSIチップの 内部電源VDDは、ここでは3 [V] であるとする。図 12に示す入力回路は、同一LSIに内蔵された、上記 第5の実施形態の出力回路等の、出力回路に用いられる セレクト信号SELを生成する回路である。入力端子I Nは、図示しない外部回路あるいは外部回路の電源VC Cに接続され、外部回路の"H"レベルが内部電源VD Dと同じであるか、内部電源VDDより高いレベル(例 えば5[V])であるかを検出するための端子である。

【0104】NMOSトランジスタN31は、そのゲー ト電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極 が入力端子INに接続されている。NMOSトランジス タN32は、そのゲート電極およびソース電極が接地電 源GNDに接続され、そのドレイン電極がNMOSトラ ンジスタN31のソース電極に接続されている。抵抗R 31は、その一端が入力端子INに接続され、他端がノ ードIN1に接続されている。 PMOSトランジスタP 31は、そのゲート電極がノードIN1に接続され、そ のソース電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイ ン電極とバルクとが共通接続されている。PMOSトラ ンジスタP32は、そのゲート電極が内部電源VDDに 接続され、そのドレイン電極がノードIN2に接続さ れ、そのソース電極がノードN1に接続され、そのバル クがPMOSトランジスタP31のドレインおよびパル **クに接続されている。PMOSトランジスタP31およ** び32のバルクは内部電源VDDには接続されおらず、 これにより入力端子INから内部電源VDDに電流が流 れ込むのを防止する。

【0105】NMOSトランジスタN33~N36は、 直列接続されており、それぞれのゲート電極が内部電源 40 VDDに共通接続されている。この直列回路の一端にあ るNMOSトランジスタN33のドレイン電極はノード IN2に接続されており、また他端にあるMOSトラン ジスタN36のソース電極は接地電源GNDに接続され ている。NMOSトランジスタN37は、その第1電極 がノードIN2に接続され、その第2電極がノードIN 3に接続されている。インバータINV31は、その入 力端子がノードIN3に接続され、その出力端子がノー ドIN4に接続されている。インバータINV32は、

50 その入力端子がノードIN4に接続され、その出力端子

が出力端子OUTに接続されている。

【0106】図13は同一のLSI40(3 [V]の内部電源VDD)に内蔵された第6の実施形態の入力回路(図12参照)および上記第5の実施形態の出力回路42(図9参照)と、外部電源VCCで動作する外部回路43との接続例を示す図であり、(a)は外部電源VCCが5 [V]のときの接続例を示し、(b)は外部電源VCCが3 [V]のときの接続例を示す。図13(a)においては、出力回路42の出力端子OUTに、一端が外部電源VCCに接続されたプルアップ抵抗R1の他端を接続する。図13(a)、(b)において出力回路42の出力端子OUTは外部回路43に接続されており、入力回路41の入力端子INは外部電源VCCに接続されており、入力回路41の入力端子INは外部電源VCCに接続されている。また入力回路41の出力端子OUTは出力回路42のセレクト入力端子SELに接続されている。

【0107】図14は第6の実施形態の入力回路における入力端子INへの入力電圧に対する各部のDC特性図である。図14には、入力端子IN、出力端子OUT、ノードIN2、およびノードIN3の電圧特性を示してある。

【0108】次に、図12に示す入力回路(図13にお ける入力回路41)の動作を説明する。まず、図13 (a) のように接続されたときの動作、すなわちLSI チップが5 [V] 動作の外部回路に接続されたときの動 作を説明する。入力端子INが5 [V] であり、ノード IN1が内部電源VDDレベル (3 [V]) 以上となる ので、PMOSトランジスタP31はOFFし、PMO SトランジスタP32はONしている。これによりノー ドIN2は内部電源VDDレベル (3 [V]) 以上とな り、NMOSトランジスタN37によりノードIN3の 電位はVDD-Vthとなる。従ってインパータINV 31の出力すなわちノードIN4は"L"レベル(0 [V] ) となり、インバータINV32の出力すなわち 出力端子OUTは"H"レベル(3 [V])となる。こ の出力電圧が図13における出力回路42のセレクト入 力端子SELに入力される。

【0109】次に、図13(b)のように接続されたときの動作、すなわちLSIチップが3[V]動作の外部回路に接続されたときの動作を説明する。入力端子INが3[V]なので、PMOSトランジスタP1およびP2はともにOFFしており、NMOSトランジスタN33~N36の直列回路によりノードIN2は"L"レベルとなる。ノードIN2が"L"レベルなので、NMOSトランジスタN37がONしており、ノードIN3は"L"レベルとなる。従ってノードIN4は"H"レベル(3[V])となり、出力端子OUTは"L"レベル(0[V])となる。

【0110】このように第6の実施形態によれば、入力端子INを外部回路の電源VCCに接続し、出力端子OUTを例えば上記第5の実施形態の出力回路のセレクト

入力端子SELに接続することにより、外部電源VCCが5 [V]のときは上記出力回路のセレクト入力端子SELを"H"レベルとすることにより、5 [V]動作の外部回路と上記出力回路とのインターフェースを実現させ、また外部電源VCCが3 [V]のときはセレクト入力端子SELを"L"レベルとすることにより3 [V]動作の外部回路と上記出力回路とのインターフェースを実現させることができる。すなわち、特に操作を要することなく、5 [V]動作の外部回路と3 [V]動作の外部回路のいずれにも、出力回路をインターフェイスさせることができる。また外部回路の動作電圧が変更されても、同じLSIチップおよびプリント基板を用いることができる。

【0111】尚、図12に示す入力回路は、上記の出力回路と同じLSIに内蔵されてなくても良い。また電源電圧=3Vに対して、外部入力=5Vで説明したが、他の条件でも構わない。内部電源電圧よりも外部電源電圧が高い条件に対して有効である。

【0112】第7の実施形態

20 図15は本発明の第7の実施形態の入力回路を示す回路 図である。図15に示す入力回路は、入力端子INと、 出力端子OUTと、PMOSトランジスタP31、P3 2、P38、P39と、NMOSトランジスタN31~ N39と、インバータINV32と、抵抗R31とを有 する。図15に示す入力回路は、図12の入力回路において、PMOSトランジスタP38、P39と、NMO SトランジスタN38、N39とを設け、インバータINV31を取り外したものである。出力回路および外部 回路との接続は、上記第6の実施形態と同じとする(図 30 13参照)。

【0113】NMOSトランジスタN38は、そのゲートがノードIN3に接続され、そのドレイン電極がノードIN4に接続され、そのソース電極が接地電源GNDに接続されている。PMOSトランジスタP38は、そのゲート電極がノードIN4に接続され、そのドレイン電極がノードIN4に接続され、そのソース電極およびバルクがノードSPNに接続されている。PMOSトランジスタP38のパルクは内部電源VDDには接続されていない。PMOSトランジスタP39は、そのゲートが出力端子OUTに接続され、そのドレイン電極がノードSPNに接続され、そのソース電極が内部電源VDDに接続されている。NMOSトランジスタN39は、そのゲート電極が出力端子OUTに接続され、そのドレイン電極が内部電源VDDに接続され、そのソース電極がノードSPNに接続されている。

【0114】図16は第7の実施形態の入力回路における入力端子INへの入力電圧に対する各部のDC特性図であり、(a)は入力端子IN、出力端子OUT、ノードIN3、およびノードSPNの電圧特性、(b)は電源電流特性(内部電源VDDに対する消費電流特性)を

50

示す。

【0115】次に、図15に示す入力回路の動作は、図 12に示した入力回路の動作とほぼ同じである。ただし 以下に説明する点が異なる。

35

【0 1 1 6】入力端子 I Nが 5 [V] の外部電源 V C C に接続されたとき、ノードIN3の電位はVDD-Vt hとなるので、NMOSトランジスタN38はONし、 出力端子OUTは"H"レベル(3 [V])となる。出 カ端子OUTが"H"レベルなので、PMOSトランジ スタP39はOFFしており、NMOSトランジスタN 39はONしており、ノードSPNの電位はVDD-V thとなる。従ってノードIN3とノードSPNの電位 がともにVDD-Vthとなり、PMOSトランジスタ P38を確実にOFFさせることができるので、内部電 源電位VDDからPMOSトランジスタP38およびN MOSトランジスタN38を経由して接地電源GNDに 電流が流れ込むことを防止することができる。また入力 端子INが3 [V] の外部電源VCCに接続されたとき は、NMOSトランジスタN38、N39はOFFし、 PMOSトランジスタP38、P39はONしている。 【0117】このように第7の実施形態によれば、入力 端子INを外部回路の電源VCCに接続し、出力端子〇 UTを例えば第5の実施形態の出力回路のセレクト入力 端子SELに接続することにより、外部電源VCCが5 [V] のときは上記出力回路のセレクト入力端子SEL を"H"レベルとすることにより、5 [V]動作の外部 回路と上記出力回路とのインターフェースを実現させ、 また外部電源VCCが3 [V] のときはセレクト入力端 子SELを"し"レベルとすることにより3 [V] 動作 の外部回路と上記出力回路とのインターフェースを実現 させることができる。すなわち、特に操作を要すること なく、5 [V] 動作の外部回路と3 [V] 動作の外部回 路のいずれにも、出力回路をインターフェイスさせるこ とができる。また外部回路の動作電圧が変更されても、 同じLSIチップおよびプリント基板を用いることがで きる。また内部電源VDDから接地電源GNDへの電流 の流れ込みを防止することができる。

【0118】尚、図15に示す入力回路は、上記の出力回路と同じLSIに内蔵されてなくても良い。

#### 【0119】第8の実施形態

図17は本発明の第8の実施形態の入力回路を示す回路 図である。図17に示す入力回路は、LSIチップに内 蔵されており、入力端子INと、出力端子OUTと、P MOSトランジスタP1~P7と、NMOSトランジスタN1~N4、N7と、インバータINV2とを有す る。このLSIチップの内部電源VDDは、ここでは3[V]であるとする。入力端子INは、外部から信号電 圧が入力される端子である。この入力信号の"H"レベルは、ここでは5[V]であるとする。また出力端子OUTはこのLSIチップに内蔵された他の回路に接続さ

れている。インバータINV2は、その入力端子が出力端子OUTに接続され、その出力端子が内部ノードOUTNに接続されている。

【0120】NMOSトランジスタN1は、そのゲート 電極およびソース電極が接地電源GNDに接続されている。NMOSトランジスタN2は、そのゲート電極が内 部電源VDDに接続され、そのドレイン電極が入力端子 INに接続され、そのソース電極がNMOSトランジスタN1のドレイン電極に接続されている。NMOSトランジスタN3は、そのゲート電極がノードOUTNに接続され、そのソース電極が接地電源GNDに接続されている。NMOSトランジスタN4は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極が内部に接続され、そのソース電極がNMOSトランジスタN3のドレイン電極に接続されている。

【0121】PMOSトランジスタP1は、そのゲート電極およびソース電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極が内部ノードSに接続されている。PMOSトランジスタP2は、そのゲート電極がノードGに接続され、そのドレイン電極が入力端子INに接続され、そのソース電極がノードSに接続されている。PMOSトランジスタP3は、そのゲート電極がノードGに接続され、そのソース電極がノードSに接続されている。PMOSトランジスタP4は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極がノードGに接続され、そのソース電極が入力端子INに接続されている。PMOSトランジスタP5は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのソース電極が入力端子INに接続されている。

30 【0122】NMOSトランジスタN7は、そのゲート 電極が内部電源VDDに接続され、その第1電極(ドレイン電極またはソース電極)が入力端子INに接続され、その第2電極(ソース電極またはドレイン電極)が 出力端子OUTに接続されている。PMOSトランジスタP7は、そのゲート電極がノードGに接続され、その 第1電極(ドレイン電極またはソース電極)が出力端子 OUTに接続され、その第2電極(ソース電極またはドレイン電極)が入力端子INに接続されている。PMO SトランジスタP6は、そのゲート電極およびソース電 極が内部電源VDDに接続され、ドレイン電極が出力端子OUTに接続されている。

【0123】PMOSトランジスタP2、P3、P4、P5、P7は共通のバルク(基板)Bに形成されている。このフローティングバルクBは、内部電源VDDおよび接地電源GNDのいずれにも接続されていないNウエルである。PMOSトランジスタP3、P5のドレイン電極はフローティングバルクBに接続されている。PMOSトランジスタP1、P6、P21のバルクは内部電源VDDに接続されており、NMOSトランジスタN1~N4、N7のバルクは接地電源GNDに接続されて

50

いる。

【0124】入力端子INには、PMOSトランジスタ P2のドレイン電極と、P4、P5の各ソース電極と、 P 7 の第 2 電極と、NMOSトランジスタN 2 のドレイ ン電極と、N7の第1電極と、インパータINV2の入 力端子とが接続されている。

37

【0125】ノードGには、PMOSトランジスタP 2、P3、P7の各ゲート電極と、P4のソース電極 と、NMOSトランジスタN3のドレイン電極とが接続 されている。ノードSには、PMOSトランジスタP1 のドレイン電極と、P2、P3の各ソース電極とが接続 されている。出力端子OUTには、PMOSトランジス タP6のドレイン電極と、P7の第1電極と、NMOS トランジスタN7の第2電極と、インパータINV2の 入力端子とが接続されている。

【0126】次に、図17に示す入力回路の動作を説明 する。入力端子INが"L"レベル(0 [V]) のと き、NMOSトランジスタN7はONしており、出力端 子〇UTは"L"レベルとなる。出力端子〇UTが" L"レベルなので、インバータINV2の出力は"H" レベルとなり、これによりNMOSトランジスタN3は ONしており、従ってN4もONしている。NMOSト ランジスタN3およびN4がONしているので、ノード Gは"L"レベルとなっている。ノードGと入力端子 I Nがともに"L"レベル(0 [V])なので、PMOS トランジスタP2、P4、P5、P7はOFFしてい る。またノードSの電位はVth以下となっており、P MOSトランジスタP3もOFFしている。

【0127】次に入力端子INが"L"レベル(0 [V] )から5 [V] に変化すると、出力端子OUTは 内部電源VDDレベルに変化する。入力端子INがVt **h(NMOSトランジスタのしきい値であり、かつPM** OSトランジスタのしきい値の絶対値)まで上昇する と、ノードGが"L"レベルなので、PMOSトランジ スタP7がターン〇Nする。またNMOSトランジスタ N7は、入出力端子YPADの電位が3 [V] -Vth 以下であるときONしており、3 [V] - V t n以上と なるとターン〇FFする。従って、入力端子INが3 [V] まで上昇したとき、PMOSトランジスタP7お よびNMOSトランジスタN7により、出力端子OUT は3 [V] - V thではなく3 V [V] まで上昇する。

【0128】また入力端子INがVthまで上昇したと き、ノードGが"L"レベルなので、PMOSトランジ スタP2がターン〇Nする。PMOSトランジスタP2 のターンONにより、ノードSは入力端子INと同じ電 位に上昇し、これによりPMOSトランジスタP3もタ ーンONする。またPMOSトランジスタP2およびP 3のターンONにより、フローティングパルクBは入力 端子 I Nと同じ電位となる。 P M O S トランジスタ P 3 は、フローティングバルクBの電位を3 [V] まで確実

に上昇させ、PMOSトランジスタP2の動作をより安 定させるために設けられたものである。

【0129】入力端子INおよび出力端子OUTが3 [V] に上昇すると、インパータINV2の出力が" H"レベルから"L"レベルに変化し、これによりNM OSトランジスタN3がターンOFFする。しかし、ノ ードGは"L"レベルのままである。

【0130】このあと、プルアップ抵抗R1により、入 出力端子YPADは外部電源VCCレベル(5 [V]) まで上昇する。入出力端子YPADが3 [V] +Vth に上昇すると、PMOSトランジスタP4、P5がター ンONする。PMOSトランジスタP4のターンONに より、ノードGは"L"レベルから入力端子INと同じ 電位に変化する。ノードGと入力端子INとが同じ電位 になることにより、PMOSトランジスタP7がターン OFFする。またノードGとノードSとが同じ電位にな ることにより、PMOSトランジスタP2およびP3が ターンOFFする。またPMOSトランジスタP5のタ ーンONにより、フローティングバルクBの電位は入力 20 端子INと同じ電位となる。

【0131】そして、入力端子INが最終的に5 [V] となったとき、ノードGおよびフローティングバルク B も5 [V] となる。もしも、PMOSトランジスタP7 がターンOFFする前に、出力端子OUTの電位が3 [V] +Vthよりも高くなったときには、PMOSト ランジスタP6がターンONして、出力端子OUTの電 位を3 [V] + V t h にクランプする。またもしも、入 力端子INの電位が、-Vthよりも低くなったときに は、NMOSトランジスタN1がターンONして、入力 端子INの電位を-Vthにクランプする。またもし も、入力端子INおよびノードSの電位が、3[V]+ Vthよりも高くなったときには、PMOSトランジス タP1がターンONして、入力端子INの電位を3 [V] + V t h にクランプする。また、N M O S トラン ジスタN2、N4は、入力端子 I NおよびノードGが5 [V] となったときに、この5 [V] がNMOSトラン ジスタN1、N4のソース/ドレイン間にかからないよ うにするために設けられたものであり、このNMOSト ランジスタN2、N4により、耐圧の弱いプロセスにも 40 対応することができる。

【0132】また、入力端子INが5 [V] に保持され ているときに、PMOSトランジスタP2およびP3が OFFしていることにより、PMOSトランジスタ**P**1 のドレイン電極 (ノードS) はハイインピーダンスとな っており、ノードSおよびPMOSトランジスタP1の パルクを通して、入力端子INから内部電源VDDにリ ーク電流が流れてしまうことはない。 またフローティン グバルクBは内部電源VDDには接続していないので、 フローティングパルクBから内部電源VDDにリーク電 流が流れてしまうこともない。

【0133】このように第8の実施形態によれば、入力端子INに5 [V]の電位が入力されても、PMOSトランジスタP7およびNMOSトランジスタN7により電流の流れ込みは発生しない。

【0134】尚、電源電圧=3Vに対して、外部入力=5Vで説明したが、他の条件でも構わない。内部電源電圧よりも外部電源電圧が高い条件に対して有効である。

【0135】第9の実施形態

図18は本発明の第9の実施形態の入力回路を示す回路 図である。図18に示す入力回路は、入力端子I Nと、 出力端子OUTと、P MOSトランジスタP  $1\sim P$  7 、 P 2 1 と、N MOSトランジスタN  $1\sim N$  4 、N 7 と、 インバータI N V 2 とを有する。図1 8 において、図1 7 と共通する部分については同一符号を付してある。

【0136】図18に示す入力回路は、図17の入力回路において、PMOSトランジスタP21を設けたものである。PMOSトランジスタP21は、そのゲート電極が接地電源GNDに接続され、そのドレイン電極が出力端子OUTに接続され、そのソース電極が内部電源VDDに接続されている。PMOSトランジスタP21は、入力端子INが高インピーダンス(開放)となったときに、出力端子OUTをプルアップし、出力端子OUTのレベルを内部電源VDDレベル(3 [V])に確定するために設けられたものである。

【0137】次に、図18に示す出力回路の動作は、図17に示した第8の実施形態の入力回路の動作とほぼ同じである。ただし、以下に説明する動作、すなわち入力端子INが高インピーダンスになったときの動作が図17の入力回路とは異なる。

【0138】PMOSトランジスタP8は、常時ONしているが、その相互コンダクタンスは小さく、プルアップ抵抗と同じ動作をする。入力端子INが高インピーダンスになったとき、出力端子OUTは、フローティングとはならずに、PMOSトランジスタP8により内部電源VDDレベルにプルアップされる。また入力端子INの電位が5[V]に保持されたときには、PMOSトランジスタP7およびNMOSトランジスタP7がOFFすることにより、PMOSトランジスタP8を介して入力端子INから内部電源VDDに電流が流れ込むことはない。

【0139】このように第9の実施形態によれば、入力端子INが高インピーダンスになった場合に、出力端子OUTを内部電源VDDレベルとすることができるため、内部回路への入力信号レベルを確定できる。また、入力端子INに5[V]の電位が入力されても、PMOSトランジスタP7、NMOSトランジスタN7により、PMOSトランジスタP21を経由しての電流の流れ込みは発生しない。

【0140】第10の実施形態

図19は本発明の第10の実施形態の入力回路を示す回

路図である。図19に示す入力回路は、入力端子INと、出力端子OUTと、PMOSトランジスタP1~P7と、NMOSトランジスタN1~N4、N7、N21と、インバータINV2とを有する。図19において、図17と共通する部分については同一符号を付してある。

40

【0141】図19に示す入力回路は、図17の入力回路において、NMOSトランジスタN21を設けたものである。NMOSトランジスタN21は、そのゲート電 をが内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極が出力端子OUTに接続され、そのソース電極が接地電源GNDに接続されている。NMOSトランジスタN21は、入力端子INが高インピーダンス(開放)となったときに、出力端子OUTをプルダウンし、出力端子OUTのレベルを接地電源GNDレベル(0[V])に確定するための設けられたものである。

【0142】次に、図19に示す入力回路の動作は、図17に示した第8の実施形態の入力回路の動作とほぼ同じである。ただし、以下に説明する動作、すなわち入力20端子INが高インピーダンスになったときの動作が図17の入力回路とは異なる。

【0143】NMOSトランジスタN22は、常時ONしているが、その相互コンダクタンスは小さく、プルダウン抵抗と同じ動作をする。入力端子INが高インピーダンスになったとき、出力端子OUTは、フローティングとはならずに、NMOSトランジスタN21により接地電源GNDレベル(0[V])に確定される。

【0144】このように第10の実施形態によれば、入力端子INが高インピーダンスになったとき、NMOSトランジスタN21により出力端子OUTを接地電源レベルGNDとすることができるため、内部回路への入力信号レベル確定できる。また、入力端子INに5[V]の電位が入力されても、PMOSトランジスタP6、P7、NMOSトランジスタN7により、出力端子OUTは内部電源VDDレベルとなり、NMOSトランジスタN21のドレイン電極、ゲート電極、ソース電極間に対して5[V]の電位差は生じないため、耐圧の弱いプロセスに有効である。

【0145】第11の実施形態

40 図20は本発明の第11の実施形態の入力回路を示す回路図である。図20に示す入力回路は、入力端子INと、出力端子OUTと、PMOSトランジスタP1~P7、P22と、NMOSトランジスタN1~N4、N7、N22と、インバータINV2とを有する。図20において、図17と共通する部分については同一符号を付してある。

【0146】図20に示す入力回路は、図17の入力回路において、PMOSトランジスタP22と、NMOSトランジスタN22とを設けたものである。NMOSトランジスタN22は、そのゲート電極が内部電源VDD

に接続され、そのドレイン電極がノードA1に接続され、そのソース電極が入力端子INに接続され、そのバルクは接地電源GNDに接続されている。PMOSトランジスタP22は、そのゲート電極がノードA1に接続され、そのドレイン電極が入力端子INに接続され、そのソース電極が内部電源VDDに接続されている。このPMOSトランジスタP22のバルクはフローティングバルクBである。

【0147】次に、図20に示す入力回路の動作は、図17に示した第8の実施形態の入力回路の動作とほぼ同じである。ただし、以下に説明する動作、すなわち入力端子INが高インピーダンスになったときの動作が図17の入力回路とは異なる。

【0148】図21は図20に示す入力回路において入力端子INが0[V]または5[V]から高インピーダンスに変化したときの入力端子INとノードA1の動作タイミング図(電圧波形図)であり、(a)は入力端子INが0[V]から高インピーダンスに変化したときの電圧波形図、(b)は入力端子INが5[V]から高インピーダンスに変化したときの電圧波形図である。図21を用いて入力端子INが高インピーダンスになったときの動作を説明する。まず、入力端子INが"L"レベル(0[V])から高インピーダンスとなったときの動作を説明する。入力端子INが"L"レベル(0

[V]) のとき、NMOSトランジスタN22はONしており、JードA1は" L" レベル(0 [V]) となっている。またPMOSトランジスタP22は、ONしているがプルアップ抵抗のように動作し、P22のソース/ドレイン間には、電圧VDDがかかっている。

【0150】次に、入力端子INが5 [V]から高インピーダンスとなったときの動作を説明する。入力端子INが5 [V]のとき、ノードA1はVDD-Vthとなっている。PMOSトランジスタP22は、ONしているがプルダウン抵抗のように動作し、P22のドレイン/ソース間には電圧5 [V] -VDDがかかっている。また出力端子OUTは内部電源VDDレベル(3

[V])となっている。

【0151】そして入力端子 I Nが5 [V] から高イン ピーダンスとなると、PMOSトランジスタP22によ り入力端子 I Nは内部電源 V D D レベル (3 [V]) に 変化する。

【0152】また、入力端子INが5 [V] に保持されているときには、PMOSトランジスタP22を、PMOSトランジスタP2でP5、P7と共通のフローティ

ングバルクBに形成しているので、PMOSトランジスタP22のバルクを介して入力端子INから内部電源VDDに電流が流れ込むことはない。

42

【0153】このように第11の実施形態によれば、入力端子INが高インピーダンスになった場合に、入力端子IN(外部信号)と出力端子OUT(内部信号)のどちらとも内部電源VDDレベルとなる。また、入力端子INに5[V]が入力された場合でも、PMOSトランジスタP22~P5、P7と共通のフローティングバルクBであるため、バルクへの電流の流れ込みは発生せず、ドレイン電極(5[V])とゲート電極(VDD-Vth)間にも5[V]の電位差は生じない。従って電位差に対する耐圧

の弱いプロセスに有効である。 【0 1 5 4】第 1 2 の実施形態

図22は本発明の第12の実施形態の入力回路を示す回路図である。図22に示す入力回路は、LSIチップに内蔵されており、入力端子INと、出力端子OUTと、PMOSトランジスタP1~P7と、NMOSトランジスタN1~N4、N7、N23、N24と、インバータINV2とを有する。図22において、図17と共通する部分については同一符号を付してある。

【0155】図22に示す入力回路は、図17の入力回路において、NMOSトランジスタN23とN24とを 設けたものである。

【0156】NMOSトランジスタN23は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極がノードA2に接続され、そのソース電極が接地電源GNDに接続されている。NMOSトランジスタN24

30 は、そのゲート電極が内部電源VDDにに接続され、そのドレイン電極が入力端子INに接続され、そのソース電極がノードA2に接続されている。すなわち入力端子INと接地電源GNDの間に、NMOSトランジスタN23、N24が直列に設けられている。

【0157】次に、図22に示す入力回路の動作は、図17に示した第8の実施形態の入力回路の動作とほぼ同じである。ただし、以下に説明する動作、すなわち入力端子INが高インピーダンスになったときの動作が図17の入力回路とは異なる。

【0158】NMOSトランジスタN23およびN24は、常時ONしているが、その相互コンダクタンスは小さく、プルダウン抵抗と同じ動作をする。入力端子INが高インピーダンスになったとき、入力端子INは、フローティングとはならずに、NMOSトランジスタN23、N24により接地電源GNDレベル(0[V])に確定され、またこれにより出力端子OUTも0[V]に確定される。

【0159】このように第12の実施形態によれば、入 カ端子INが高インピーダンスになった場合に、入力端 50 子IN(外部信号)と出力端子OUT(内部信号)のど

ちらとも接地電源GNDレベルとなる。また、入力端子INに5 [V]が入力された場合でも、NMOSトランジスタN23とN24とで分圧してノードA2の電位を決定することにより、NMOSトランジスタNN23のソース/ドレイン間において5 [V]の電位差は生じないので、電位差に対する耐圧の弱いプロセスに有効である。

## 【0160】第13の実施形態

図23は本発明の第13の実施形態の入力回路を示す回路図である。図23に示す入力回路は、入力端子INと、出力端子OUTと、PMOSトランジスタP1~P7と、NMOSトランジスタN1~N4、N7、N23、N24と、インバータINV2とを有する。図23において、図17と共通する部分については同一符号を付してある。

【0161】図23に示す入力回路は、図17の入力回路において、NMOSトランジスタN1に並列に、NMOSトランジスタN23を設けたものである。NMOSトランジスタN23は、そのゲート電極が内部電源VDDに接続され、そのドレイン電極がノードA2に接続され、そのソース電極が接地電源GNDに接続されている。NMOSトランジスタN1のドレイン電極、およびNMOSトランジスタN2のソース電極は、ノードA2に接続されている。

【0162】次に、図23に示す入力回路の動作は、図17に示した第8の実施形態の入力回路の動作とほぼ同じである。ただし、以下に説明する動作、すなわち入力端子INが高インピーダンスになったときの動作が図17の入力回路とは異なる。

【0163】NMOSトランジスタN1およびN23 は、常時ONしているが、N23の相互コンダクタンス は小さい。N1およびN23の直列回路は、プルダウン 抵抗と同じ動作をする。入力端子INが高インピーダン スになったとき、入力端子INは、フローティングとは ならずに、NMOSトランジスタN1、N23により接 地電源GNDレベル(0[V])に確定され、またこれ により出力端子OUTも0[V]に確定される。

【0164】このように第13の実施形態によれば、入力端子INが高インピーダンスになった場合に、入力端子IN(外部信号)と出力端子OUT(内部信号)のどちらとも接地電源GNDレベルとなる。また、入力端子INに5[V]が入力された場合でも、NMOSトランジスタN2とN23で分圧してノードA2の電位を決定することにより、NMOSトランジスタN23のソース/ドレイン間において5[V]の電位差は生じないため、電位差に対する耐圧の弱いプロセスに有効である。また、上記第12の実施形態よりも少ないトランジスタで同等の機能を実現できる。

#### [0165]

【発明の効果】以上説明したように本発明の出力回路、

入力回路、および入出力回路によれば、内部電源電圧まで高速に動作させることができるという効果がある。また内部電源への電流の流れ込みを防止して低消費電力化を実現できるという効果がある。また耐圧の弱いプロセスに対応することができるという効果がある。またインターフェイスする内部回路または外部回路に対して充分なVIHマージンを確保することができるという効果がある。さらに内部電源よりも高い外部電源と、内部電源と同じレベルの外部電源のいずれにもインターフェース10 することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態の入出力回路を示す回路図である。

【図2】本発明の第1の実施形態の入出力回路における 動作タイミング図である。

【図3】本発明の第2の実施形態の出力回路を示す回路 図である。

【図4】本発明の第2の実施形態の出力回路における動作タイミング図である。

20 【図5】本発明の第3の実施形態の出力回路を示す回路 図である。

【図6】本発明の第3の実施形態の出力回路における動作タイミング図である。

【図7】本発明の第4の実施形態の出力回路を示す回路 図である。

【図8】本発明の第4の実施形態の出力回路における動作タイミング図である。

【図9】本発明の第5の実施形態の出力回路を示す回路 図である。

70 【図10】本発明の第5の実施形態の出力回路の外部と の接続例を示す図である。

【図11】本発明の第5の実施形態の出力回路における 動作タイミング図である。

【図12】本発明の第6の実施形態の入力回路を示す回路図である。

【図13】本発明の第6の実施形態の入力回路の外部と の接続例を示す図である。

【図14】本発明の第6の実施形態の入力回路のDC特性を示す図である。

40 【図15】本発明の第7の実施形態の入力回路を示す回 路図である。

【図16】本発明の第7の実施形態の入力回路のDC特性を示す図である。

【図17】本発明の第8の実施形態の入力回路を示す回 路図である。

【図18】本発明の第9の実施形態の入力回路を示す回 路図である。

【図19】本発明の第10の実施形態の入力回路を示す 回路図である。

50 【図20】本発明の第11の実施形態の入力回路を示す

(24)

特開平10-276081

46

回路図である。

【図21】本発明の第11の実施形態の入力回路における動作タイミング図である。

45

【図22】本発明の第12の実施形態の入力回路を示す 回路図である。

【図23】本発明の第13の実施形態の入力回路を示す 回路図である。

【図24】従来の入力回路を示す回路図である。

【図25】従来の入力回路における動作タイミング図である。

【図26】従来の出力回路を示す回路図である。

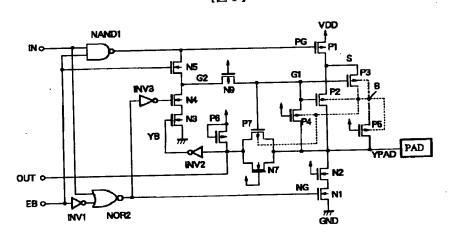
【図27】従来の出力回路における動作タイミング図である。

#### 【符号の説明】

P1~P9, P31, P32, P38, P39 PMO Sトランジスタ、 N1~N8, N31~N39 NM OSトランジスタ、 DL1 遅延回路、 INV1~ INV4, INV31, INV32 インパータ、 1 NANDゲート、 2,3 NORゲート

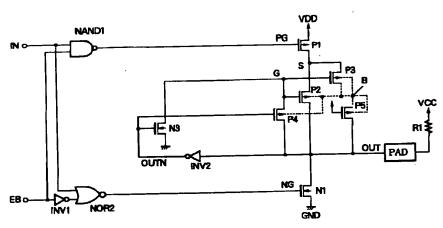
10

【図1】

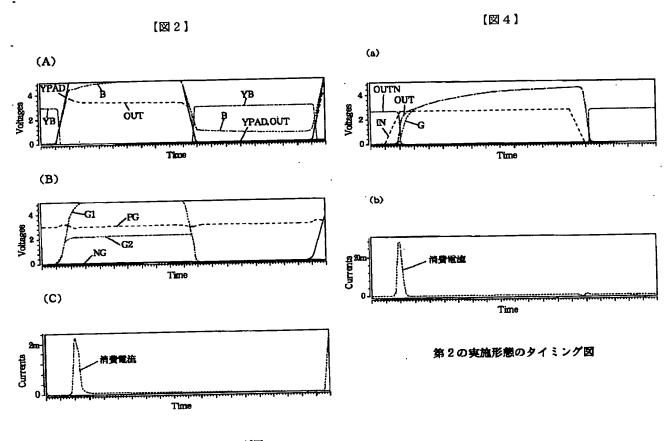


第1の実施形態

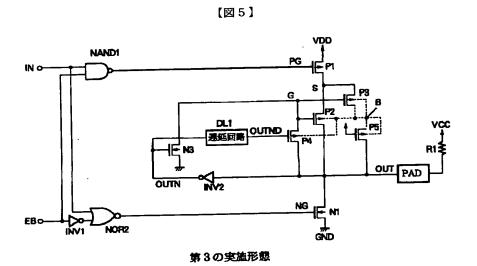
【図3】

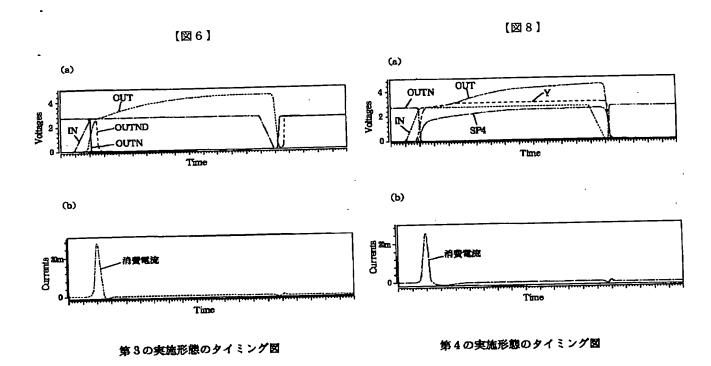


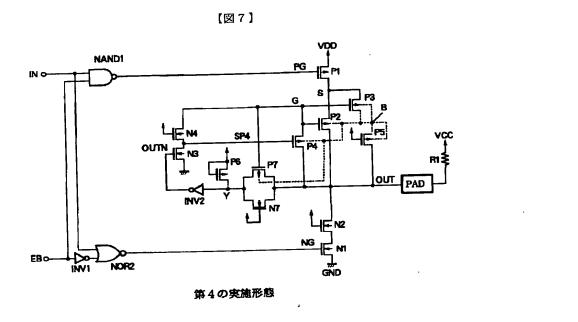
第2の実施形態

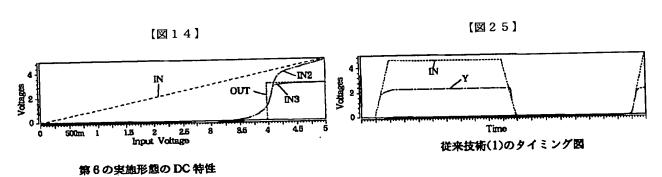


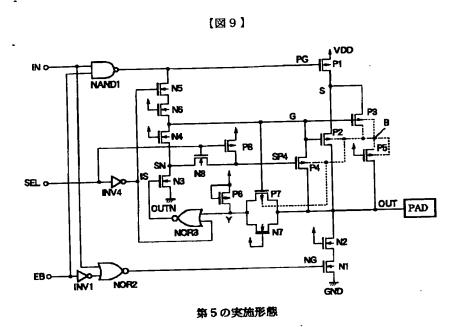
第1の実施形態のタイミング図

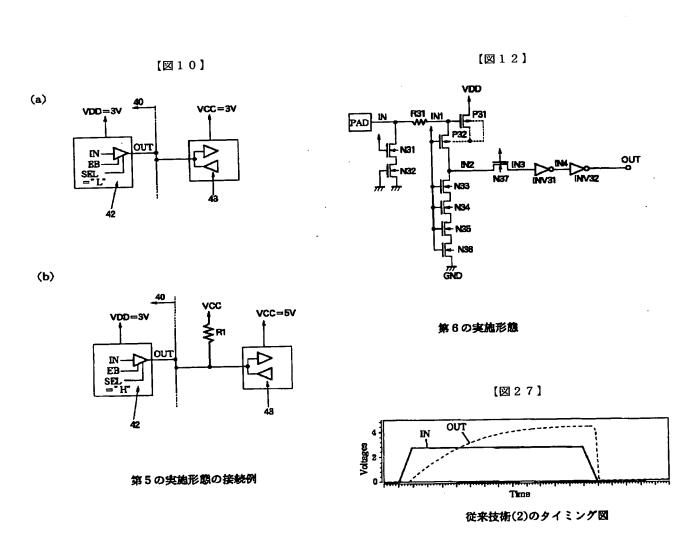




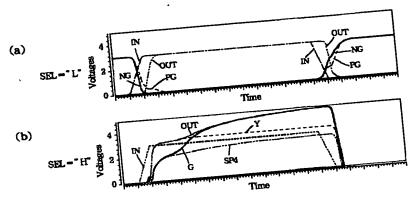






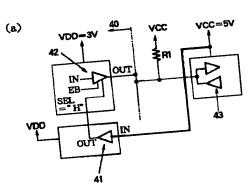


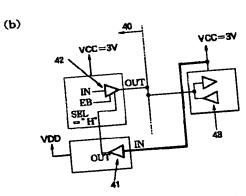
[図11]



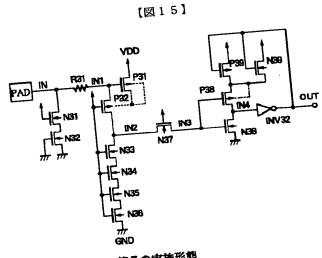
第5の実施形態のタイミング図

[図13]



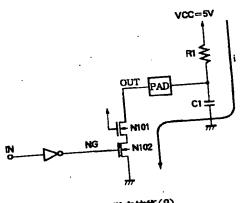


第6の実施形態の接続例

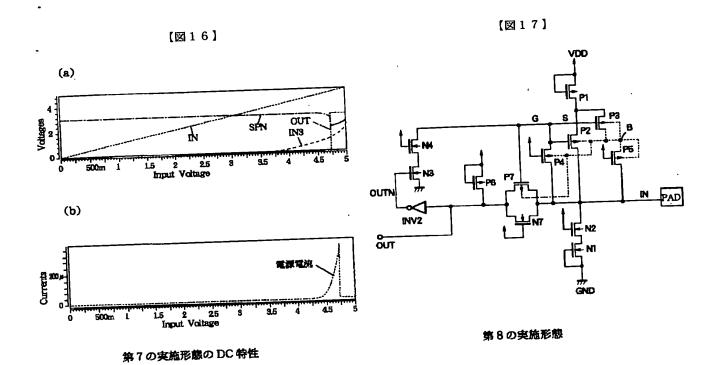


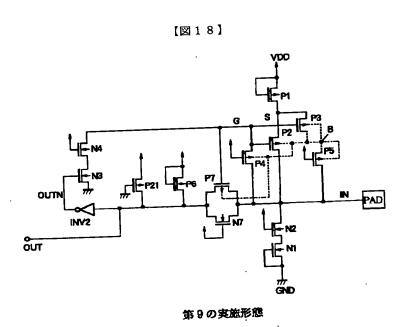
第7の実施形態

[図26]

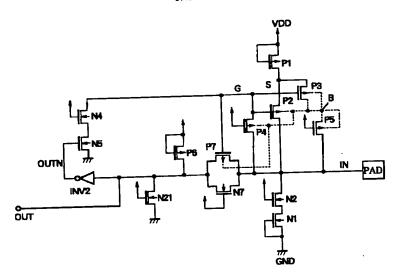


從来技術(2)



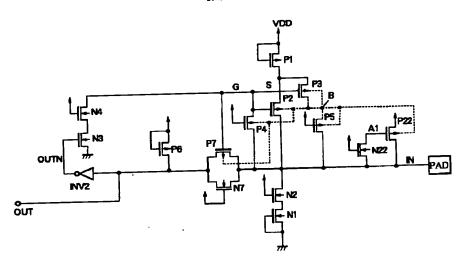


[図19]



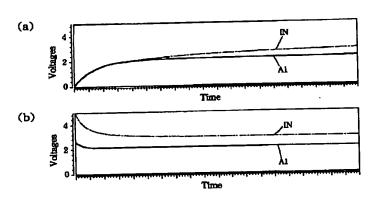
第 10 の実施形態

[図20]



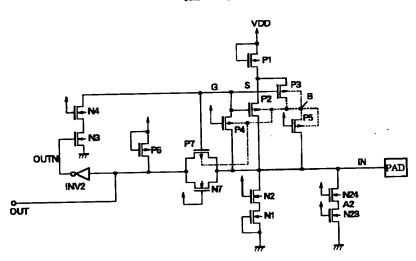
第 11 の実施形態





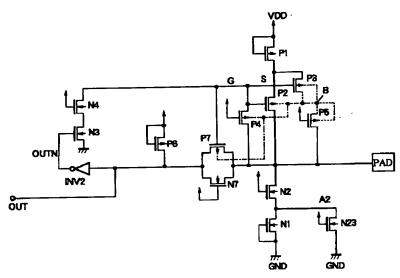
第 11 の実施形態のタイミング図

## [図22]

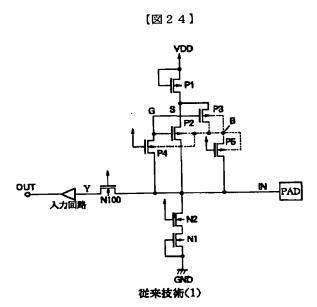


第12の実施形態





第18の実施形態



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: \_\_\_\_\_\_\_

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.